



*Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, AVČR v.v.i.  
Dolejškova 3, 182 23 Praha 8*

# **Mikroskopie rastrovací sondou I**

## **Základní a odvozené techniky**

**Pavel Janda**

*Laboratoř mikroskopie rastrovací sondou*

**Odd. elektrochemických materiálů**

**<http://www.jh-inst.cas.cz/>**

**<http://www.jh-inst.cas.cz/~janda>**

**[pavel.janda@jh-inst.cas.cz](mailto:pavel.janda@jh-inst.cas.cz)**

# Rozdělení mikroskopických metod podle rozlišení

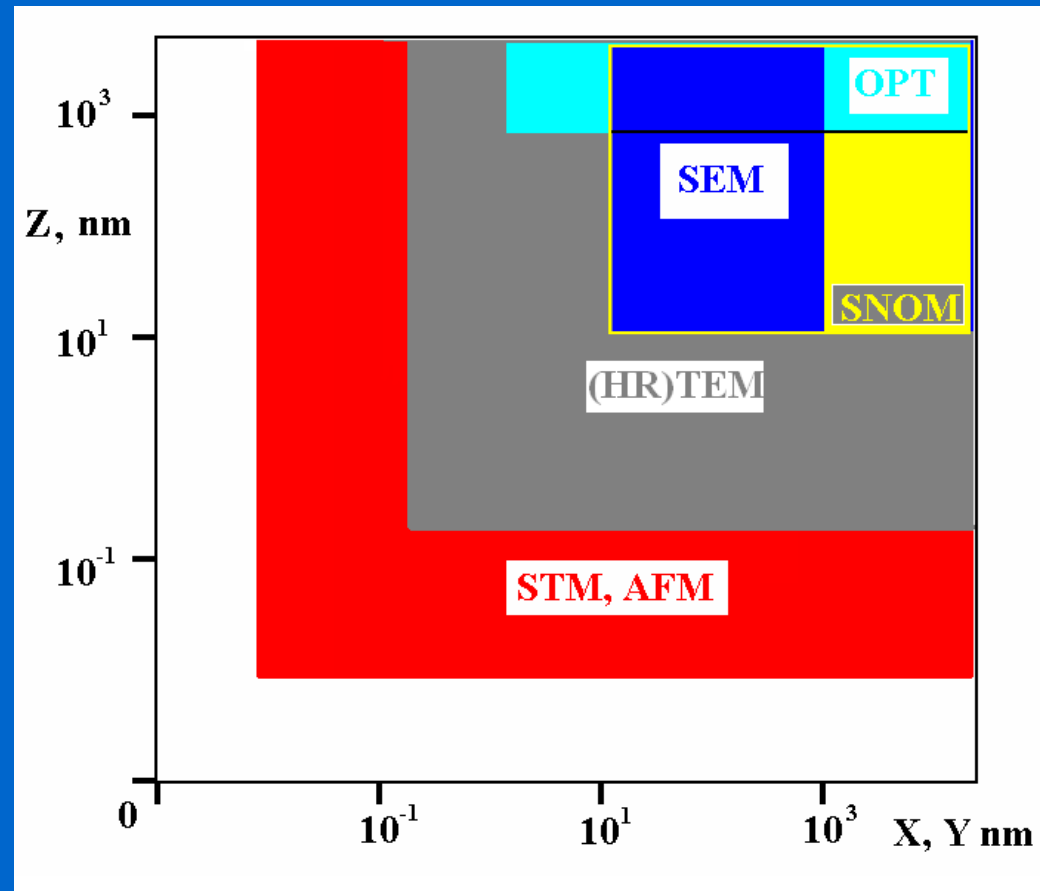
**OPT:** optická mikroskopie

**SNOM:** mikroskopie blízkého pole

**SEM:** elektron.rastr.mikroskopie

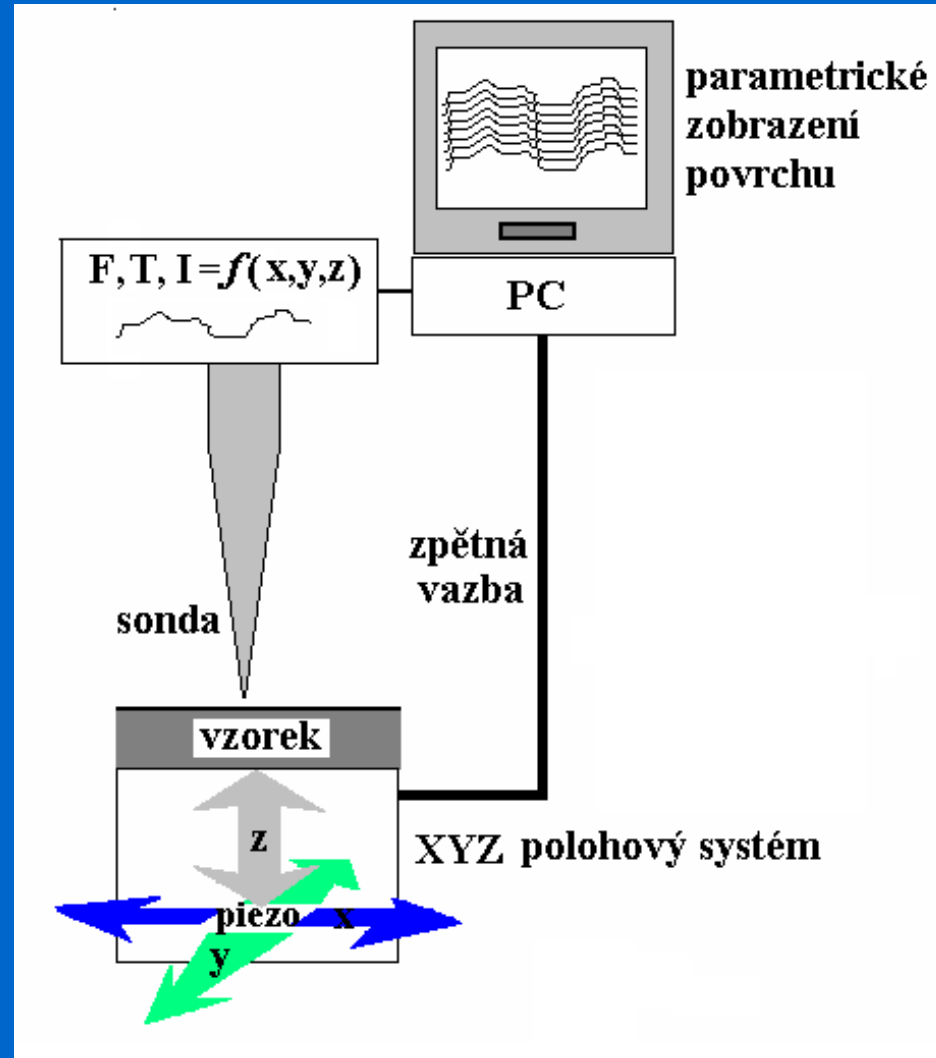
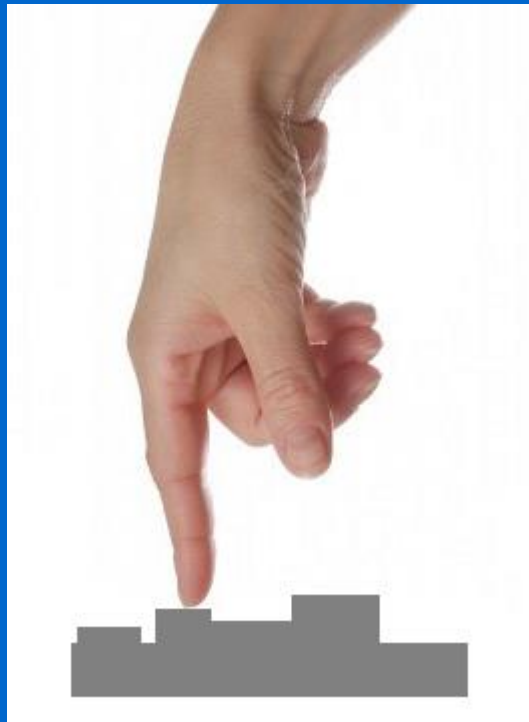
**HRTEM:** transmisní  
el.mikroskopie

**STM,AFM:**  
Tunelová mikroskopie,  
mikroskopie atomárních sil



# Mikroskopie rastrovací sondou

## Scanning Probe Microscopy



## Rozdělení SPM podle druhu přenášené informace

### Přenos náboje

Elektrony - tunelová mikroskopie **STM/ECSTM**

Ionty - elektrochemická mikroskopie **(S)ECM**

**Silové interakce** - mikroskopie atomárních sil **AFM/ECAFM**

### Přenos elektromagnetického záření

-IČ - Termální mikroskopie **ThM**

-UV/Vis/IČ - optická mikroskopie/spektr. blízkého pole **SNOM**

- Hrotem zesílená optická mikroskopie/spektr. **TERS/TEFS**

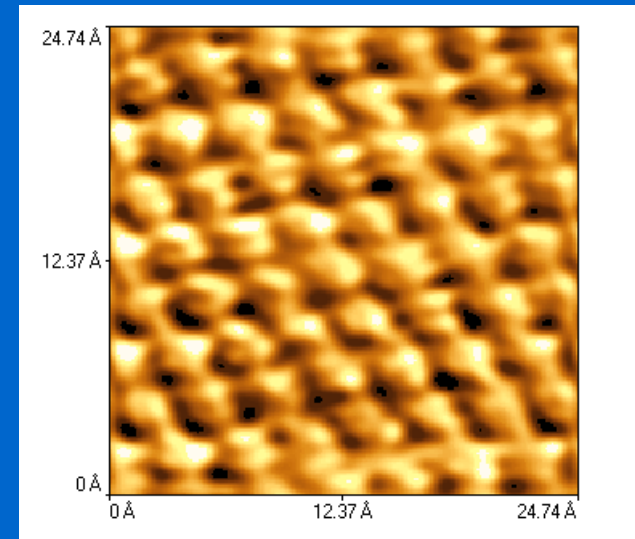
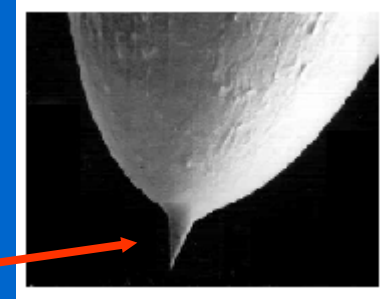
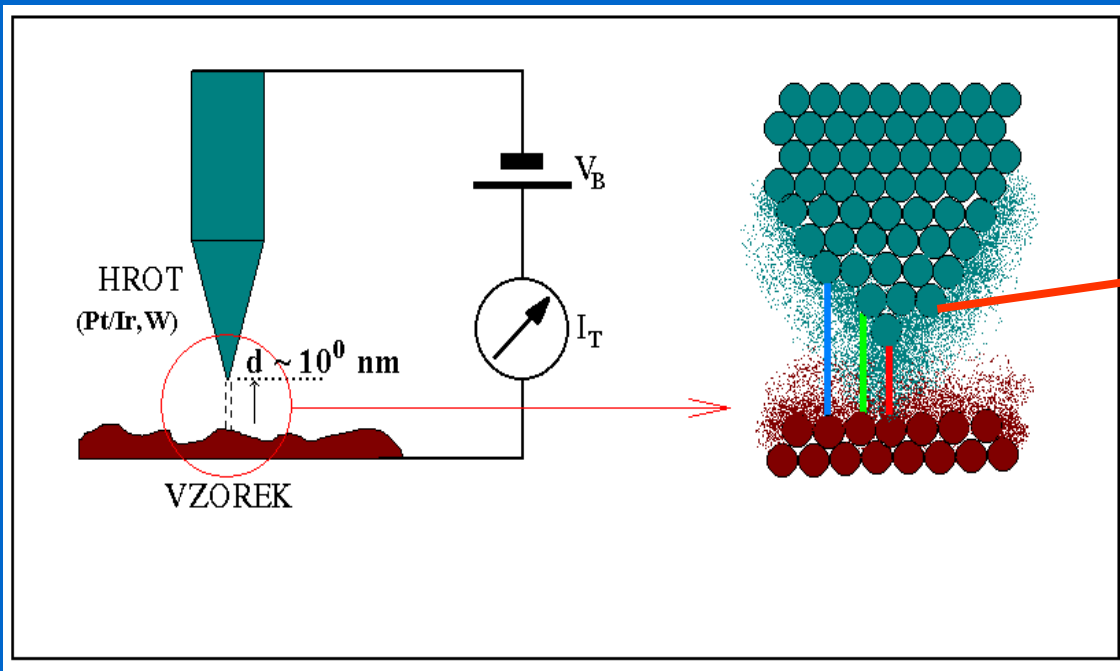
- 
- 
- 

# Tunelová mikroskopie a spektroskopie

Scanning Tunneling Microscopy,  
Scanning Tunneling Spectroscopy

# Tunelová mikroskopie

Binning, Rohrer, IBM, 1981, Nobelova cena 1986



Au(111)

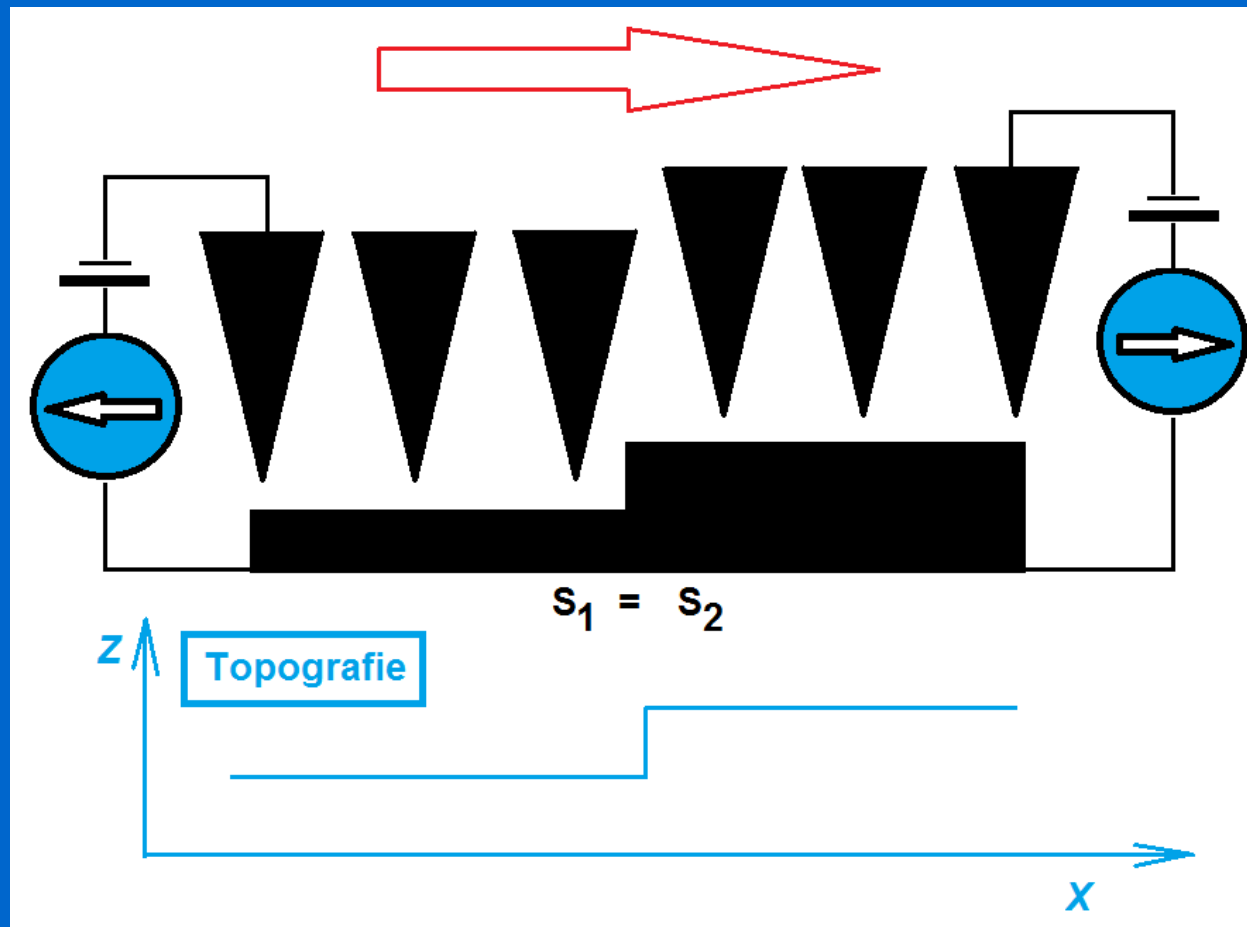
Aproximace tunelového proudu

$$I_T \sim V_B f_{mTS}(V_B) \exp[-2z\sqrt{(2m\Phi_{ST}/\hbar^2)}]$$

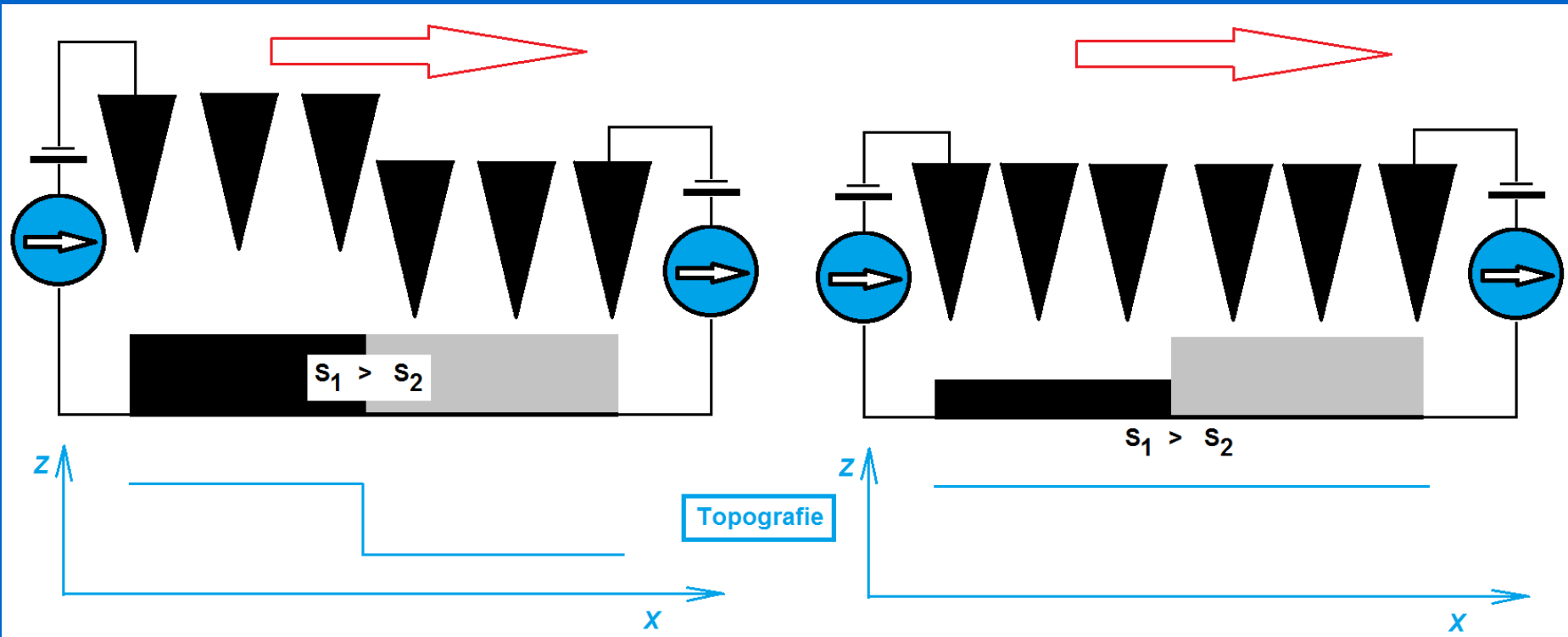
$\hbar = h/2\pi$ ,  $f_{mTS}(V_B)$ ...redukována Planck.konst.

$I_T(V_B)$  daná e-strukturou hrotu a vzorku,  
z...vzdálenost hrot-vzorek ( $\sim 10^{-1}$  nm),  $V_B$  do  $\pm 1-2$  V,  $I_T \sim$  nA-pA

# Tunelová mikroskopie - artefakty



# Tunelová mikroskopie - artefakty



# Tunelová spektroskopie barierová (distanční)

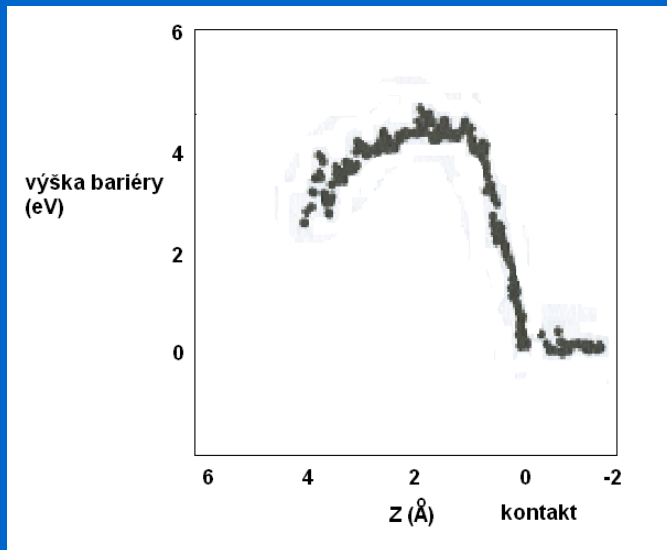
Pro nízké  $V_B = \text{konst.}$  :  $(dI_T/dZ)/I_T \sim (2\sqrt{2}m_e)/\hbar \sqrt{(\Phi_S + \Phi_T)}$

$\Phi_S$ ,  $\Phi_T$  lokální výstupní práce,  $I_T$  tunelový proud,  
 $Z$  vzdálenost hrotu od vzorku,  $m_e$  hmota e-

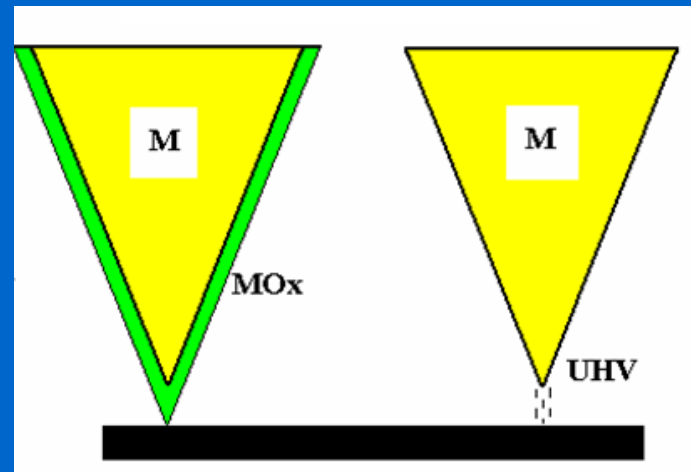
Provedení:

modulace VVVVV Z-pieza a záznam  $dI_T/dZ \Rightarrow \Phi_{S,T}$

Pro  $\Phi_T \approx \text{konst.}$ , laterální variace v měřené výšce bariéry  $\sim$  lokální  $\Phi_S$



Si-povrch, W-hrot/UHV



# Tunelová spektroskopie napěťová

$V_B < \text{výst. práce hrotu a vzorku} (\sim 10 \text{ mV})$

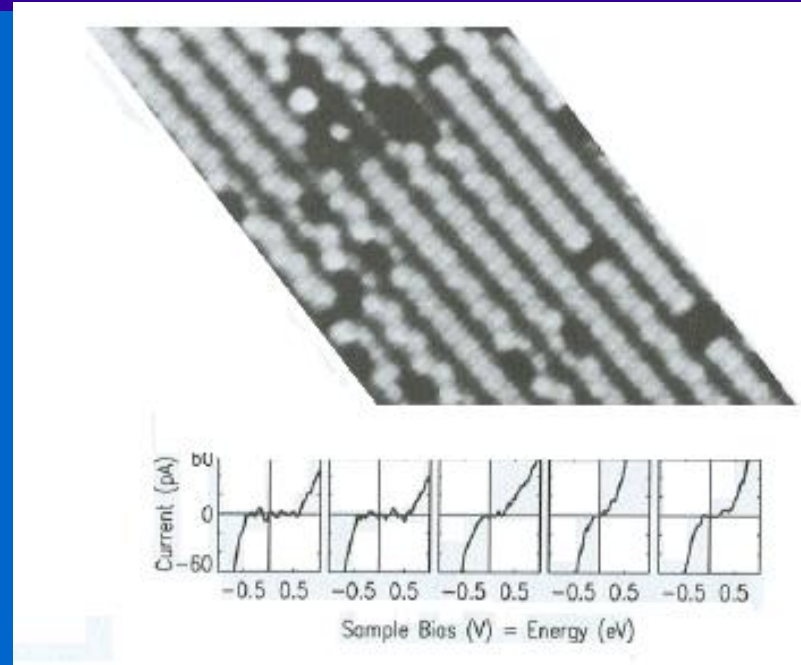
výraz  $dI_T/dV_B \approx \text{lokální povrchová hustota stavů (skutečných nebo pocházejících z uspořádání vnitřní pásové struktury vzorku)}$

Provedení:

Modulace VVVVV  $V_B$ , záznam  $I_T-V_B$  křivky

výstup: obvykle  $d(\log I_T)/d(\log V_B)$  vs  $V_B$

Poskytuje: mapu povrchových stavů (v UHV) používá se k zobrazení zaplnění stavů, ad-atomů a volných vazeb (*dangling bonds*) ...



$I_T-V_B$  křivky na monokryst Si (UHV) při průchodu hrotu nad defektem [B. Persson, A. Baratoff, *Phys.Rev.Lett.* 59, 339]

Frank, L. - Král, J., Ed.), : *Metody analýzy povrchů*. Iontové, sondové a speciální metody, Academia, Praha 2002

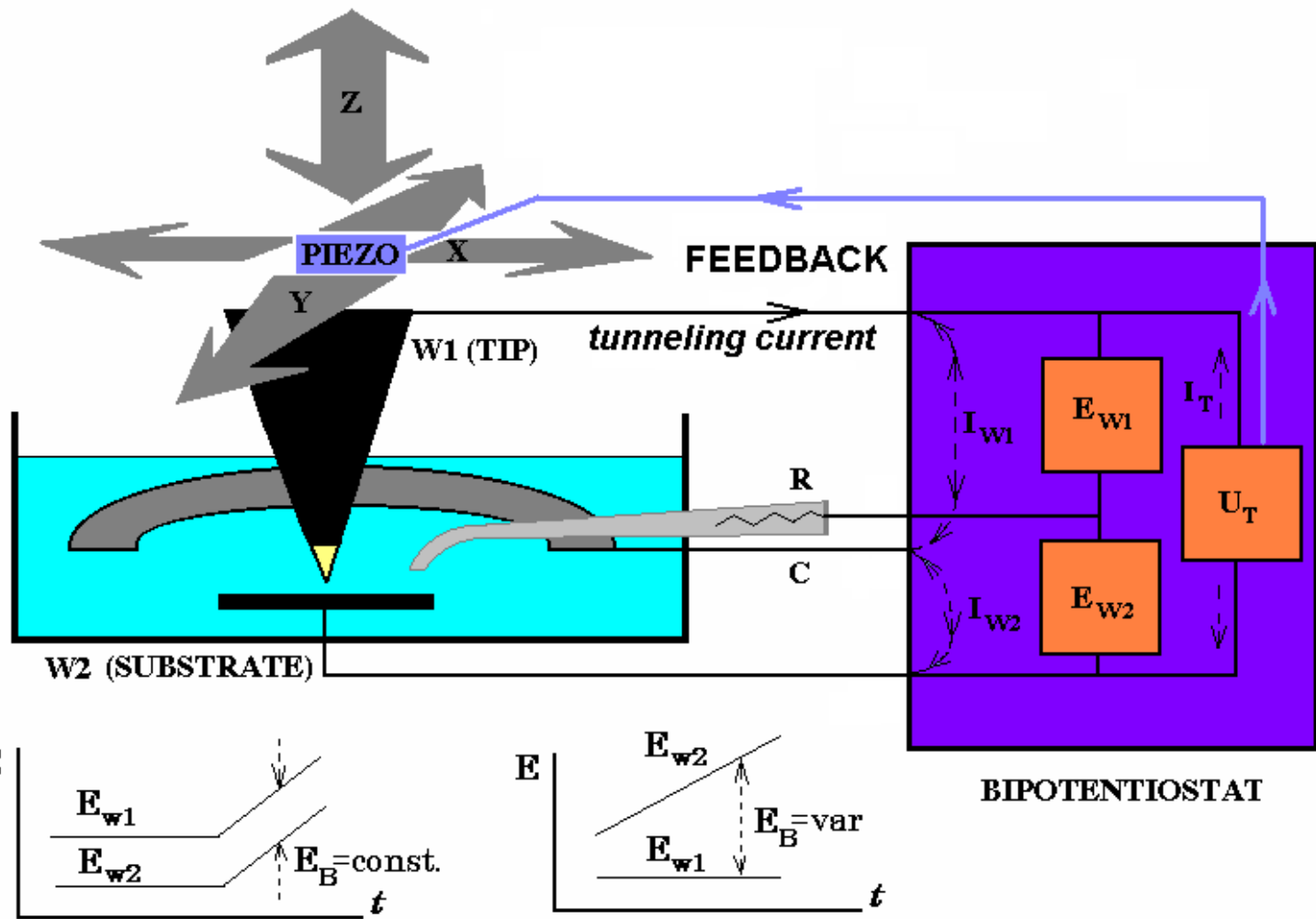
- 
- 
- 

# Elektrochemická tunelová mikroskopie

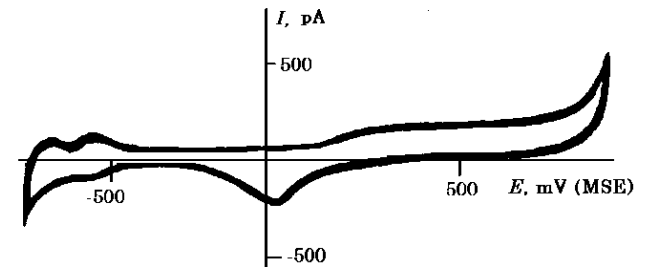
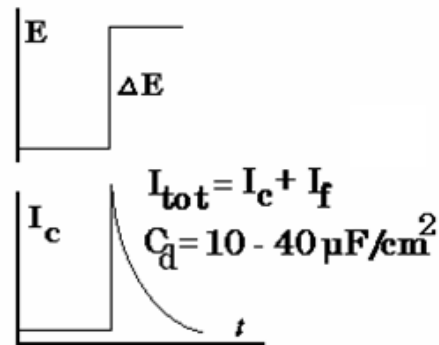
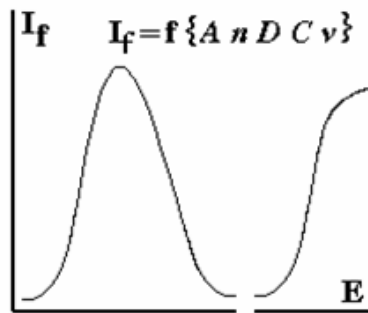
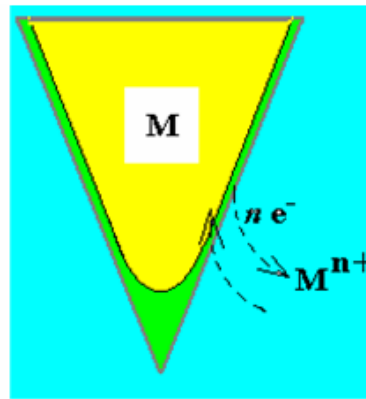
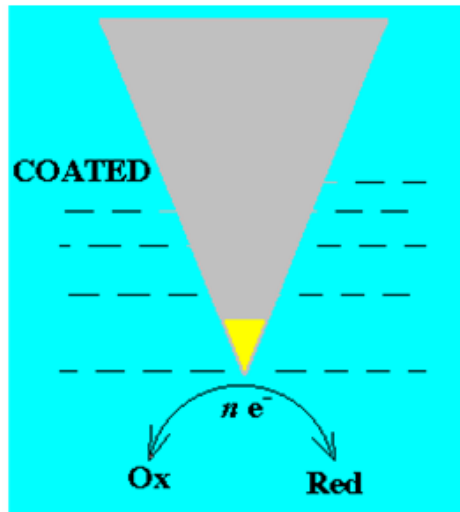
## EC STM

### Electrochemical Scanning Tunneling Microscopy

# EC STM: Detekce tunelových proudů při EC experimentu

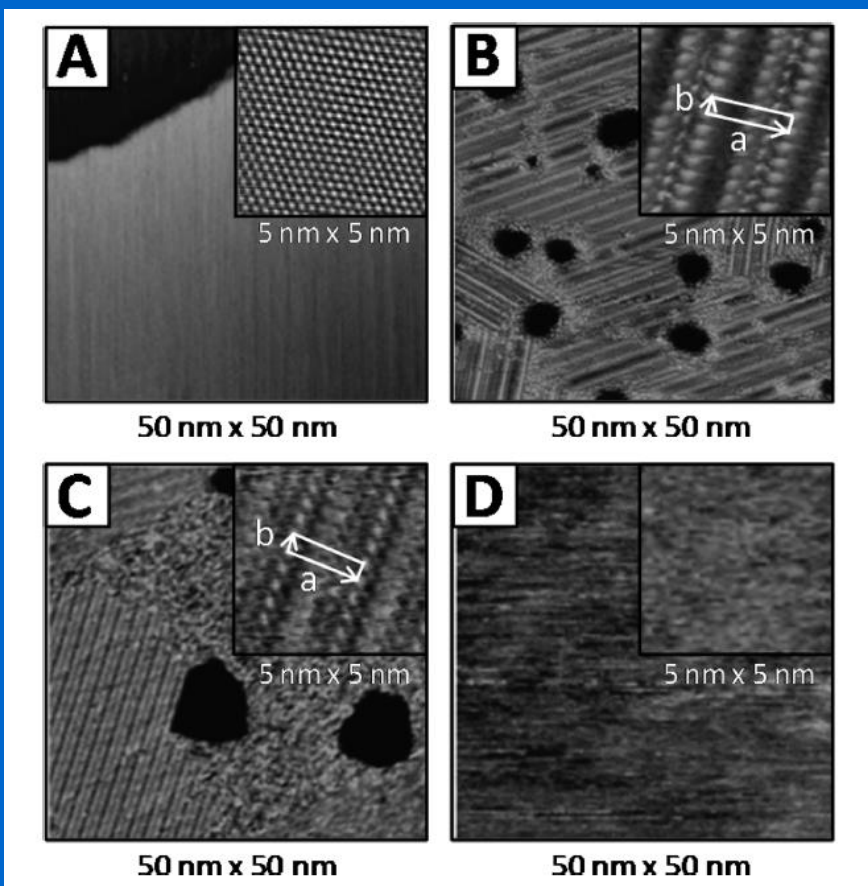


# Hrot sondy EC STM



Voltammetry of Pt-Ir STM tip (polymer coated)  
in 0.1 M  $H_2SO_4$  (deoxygenated)  
 $v = 200$  mV/sec

# EC STM: Self-Assembled Monolayers

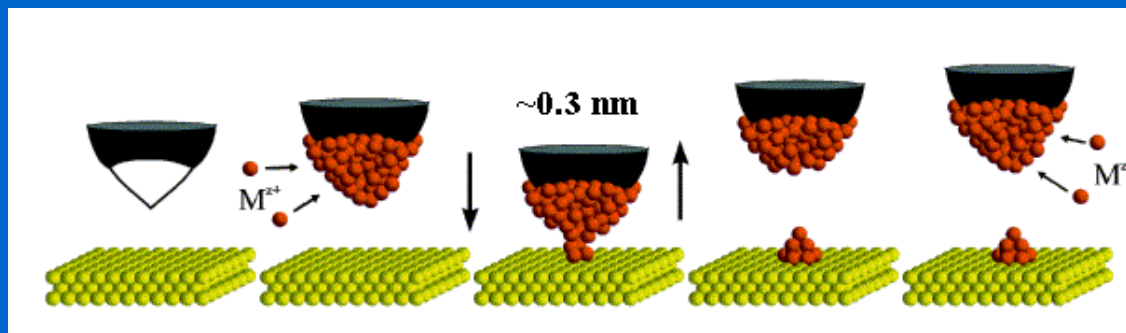
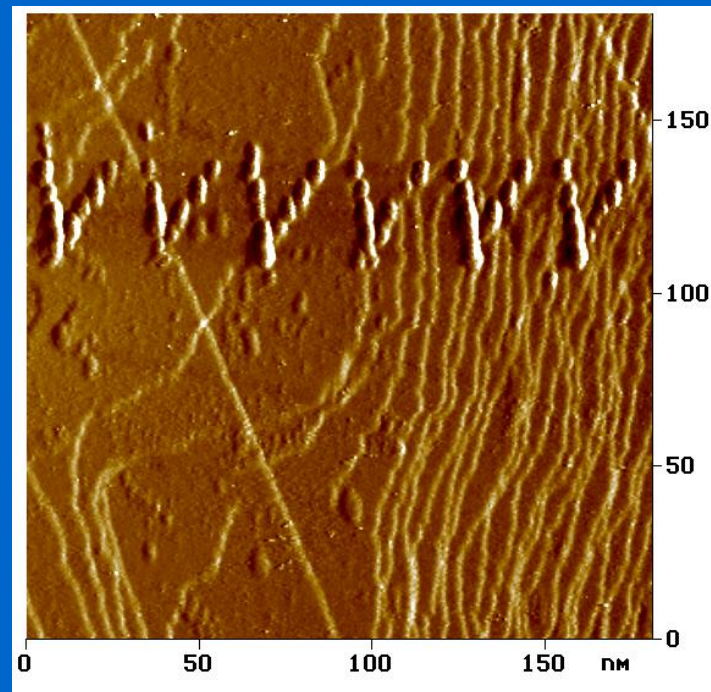
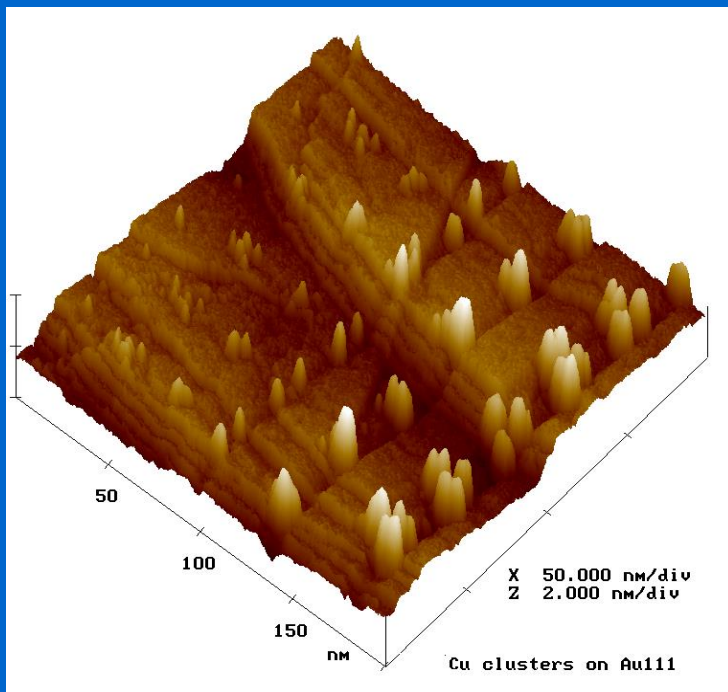


Aq. 0.1M  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ , pH 6

SAM molecular adlayer: mercaptopropionic acid (MPA) on Au111,  $U_B = 300 \text{ mV}$ ,  $I_T = 100 \text{ pA}$

V. Climent et al:  
*J. Phys. Chem. C* 2014, 118, 15754–15765

# „Nanoprint“: nanočástice $d \geq 8$ nm, $z < 1$ nm



- 
- 
- 

# Mikroskopie atomárních sil

## Atomic Force Microscopy

# AFM

## Silové interakce

Dlouhého dosahu magnetické, kulombické  
**nekontaktní režim**

Středního dosahu van der Waals (dipol-dipol, indukce dipol-nepol.)  
**semikontaktní režim**

Krátkého dosahu vazebné interakce (atraktivní), repulzivní (deformační)  
**kontaktní režim**

## Vodivostní AFM

EC AFM

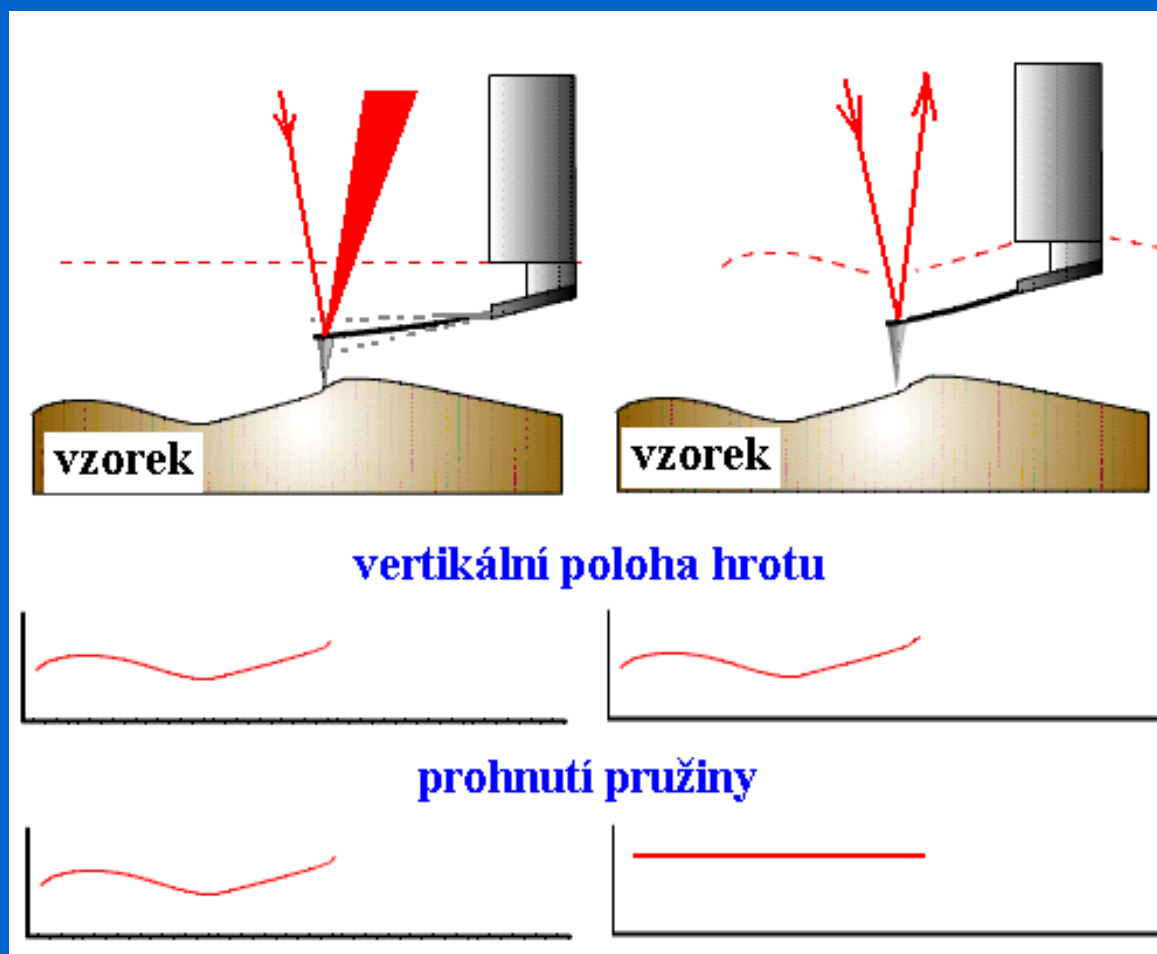
+ měření vodivosti, tunelování

+ reakce přenosu náboje/záznam Farad.proudů,

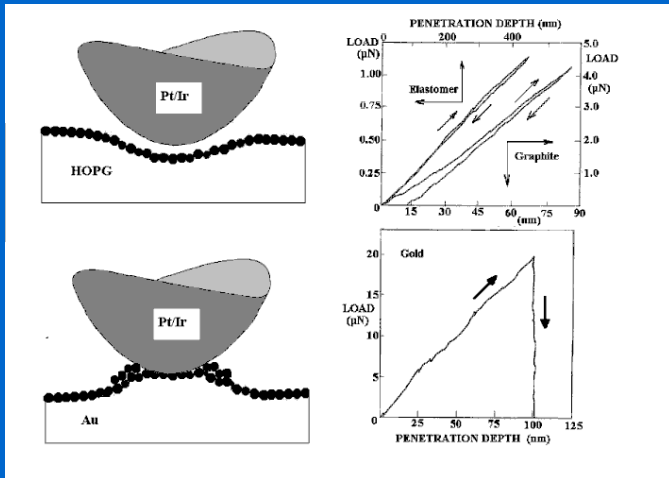
+ tip-assisted „elektro-lithografické“ techniky

+ detekce SECM

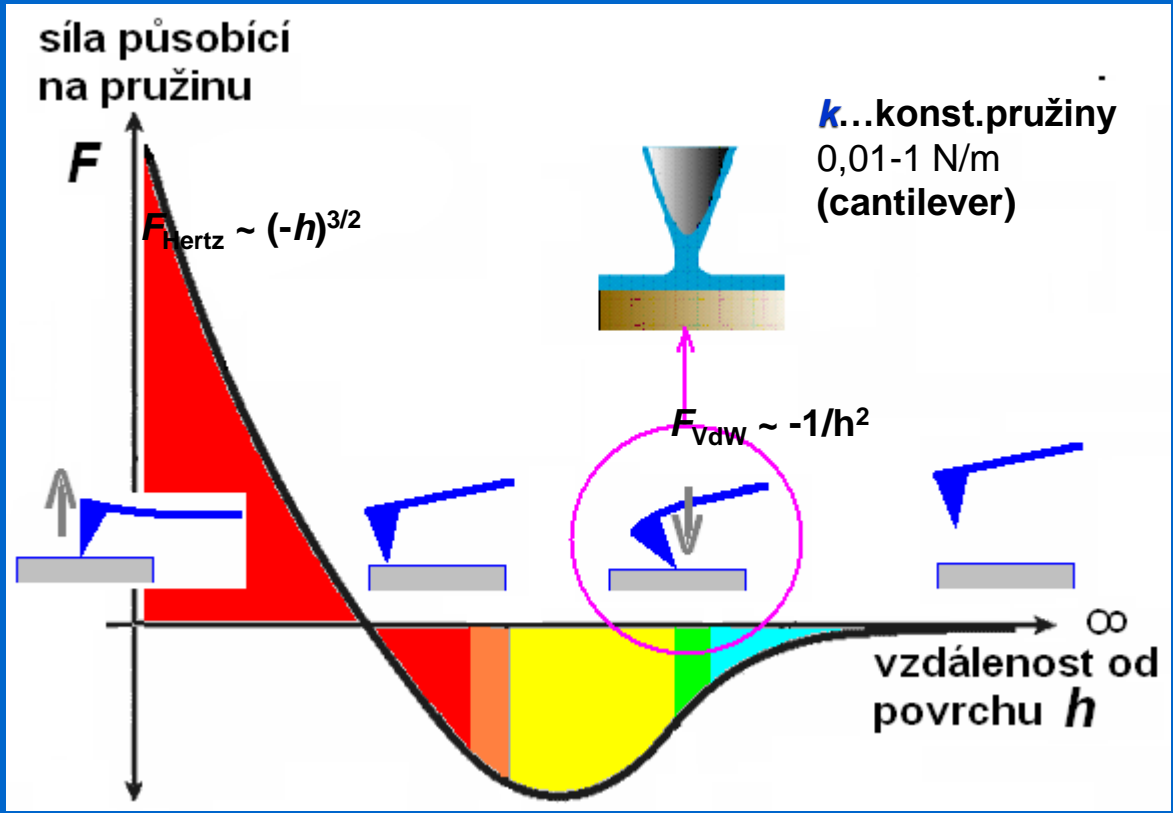
# AFM: Funkce



# AFM – silová křivka

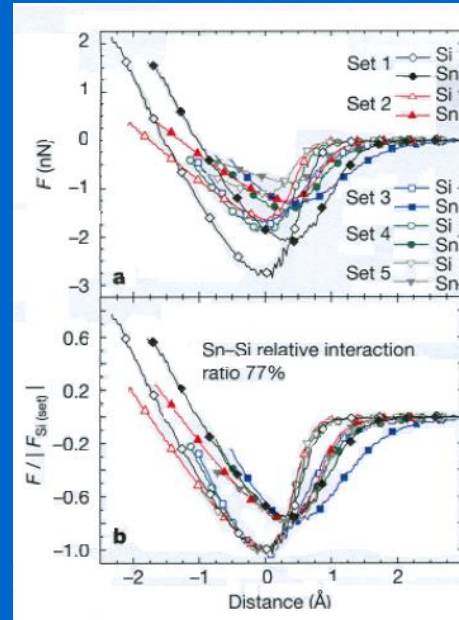
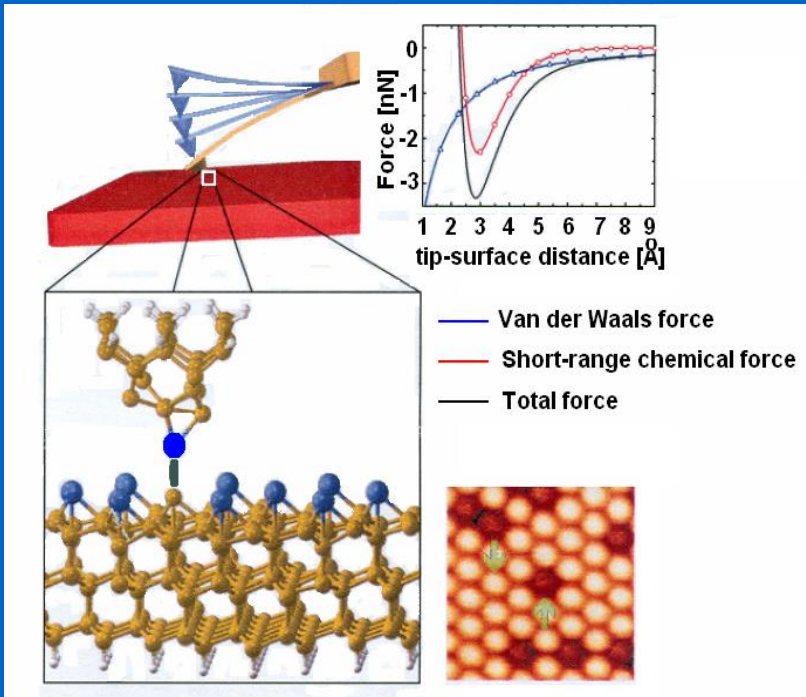


$F = -kz$  Hook



Režim: **kontaktní** **semikontaktní** **nekontaktní**  
 ( $F_{vw} 10^{-12} \text{ N}$ )

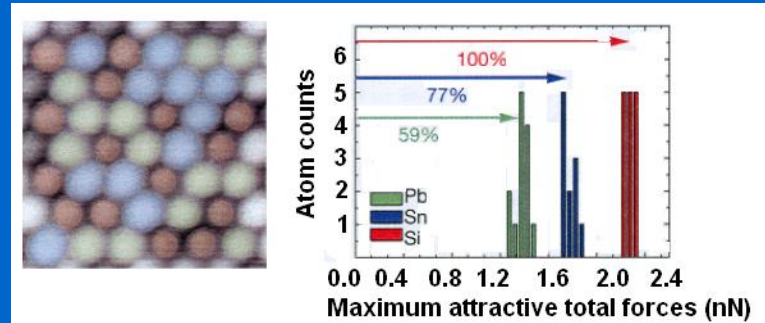
# Semikontaktní režim: Chemická identifikace atomů (UHV)



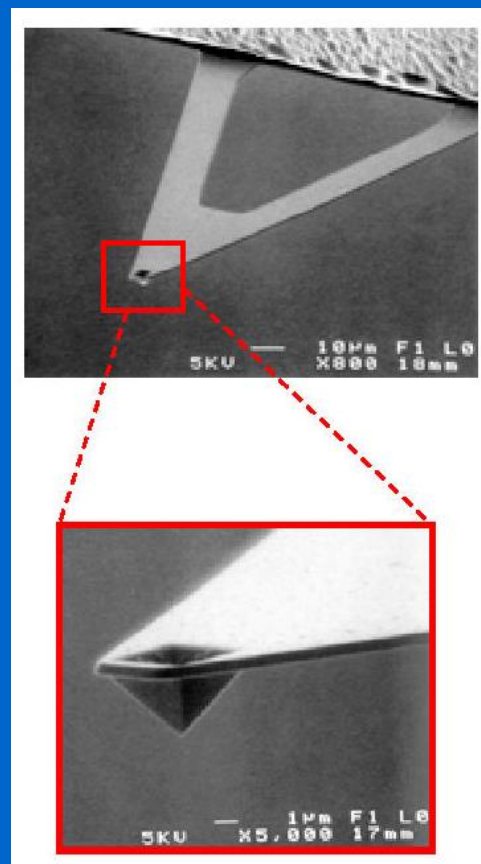
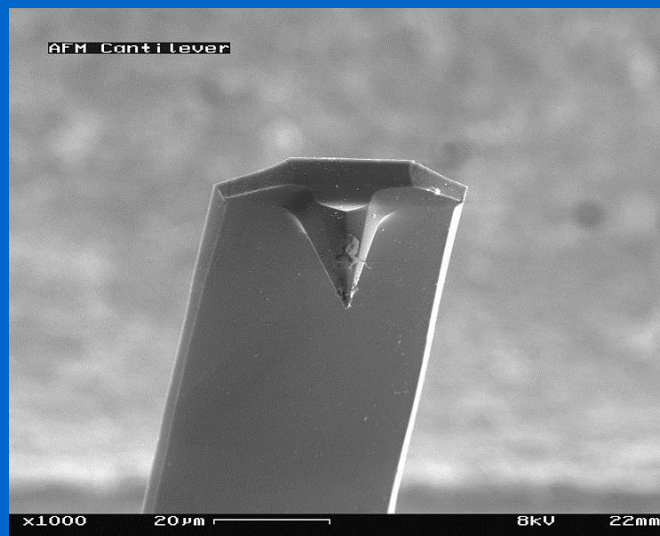
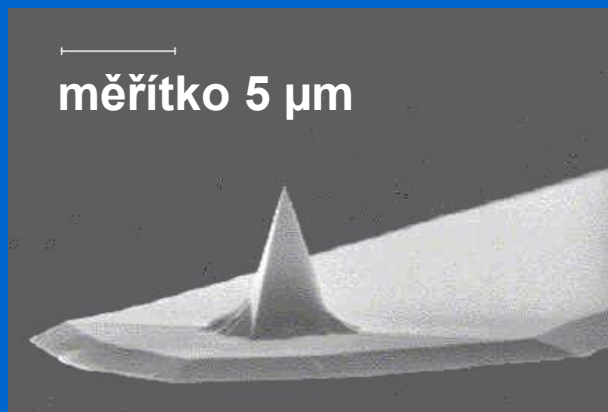
silová křivka před normalizací

křivka normalizovaná na maximum interakce substrát-hrot

Dynamic Force Spectroscopy  
silová spektroskopie  
sil blízkého dosahu – chemické interakce

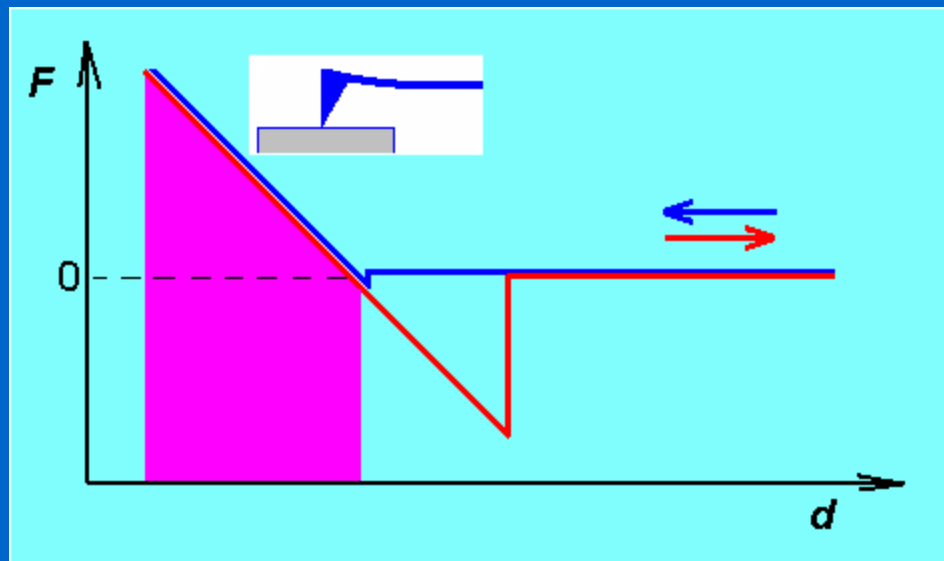


# AFM: hrot a pružina (*cantilever*)

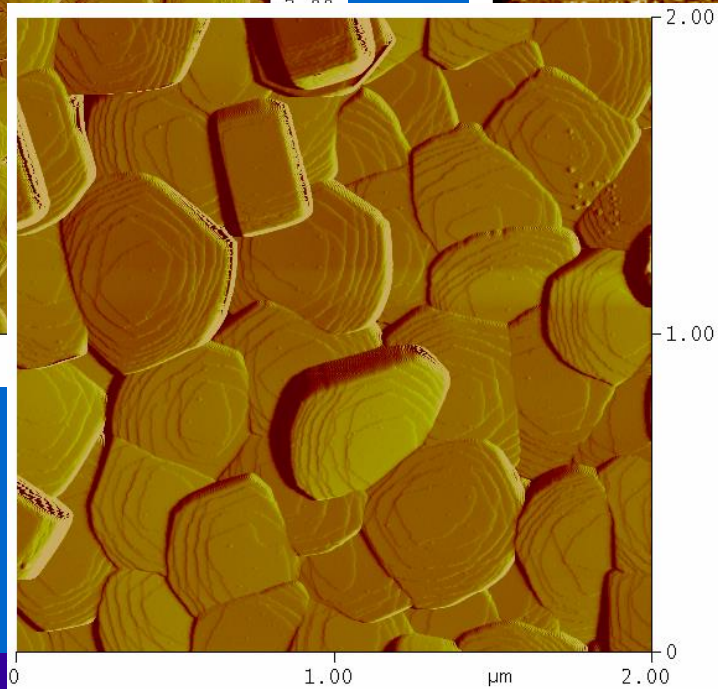
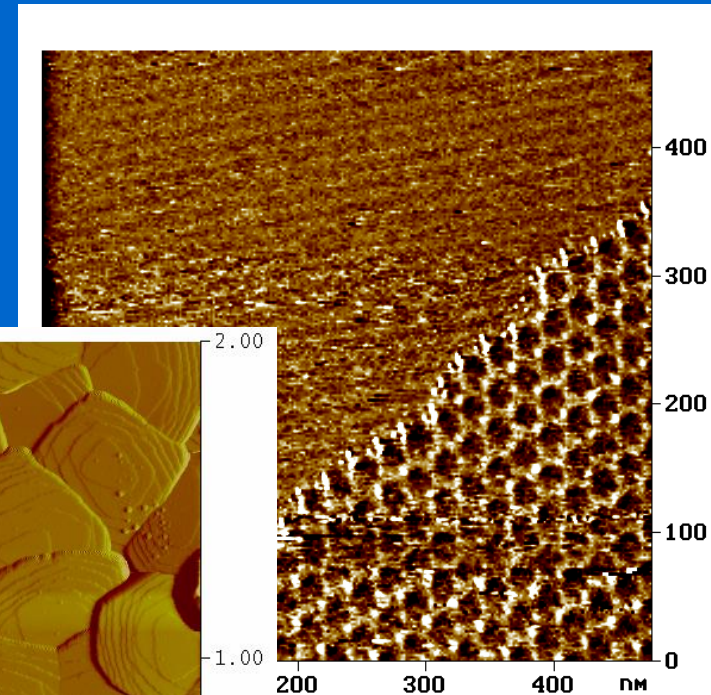
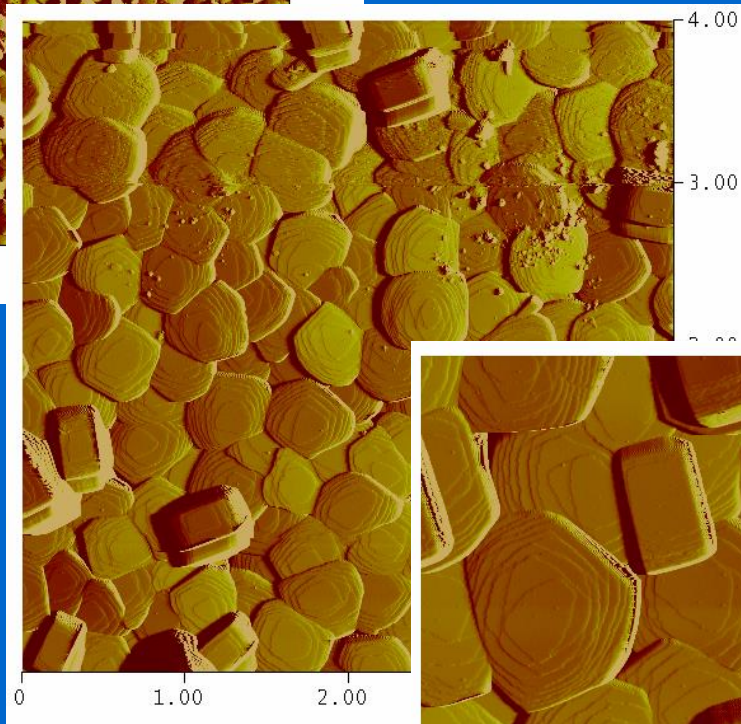
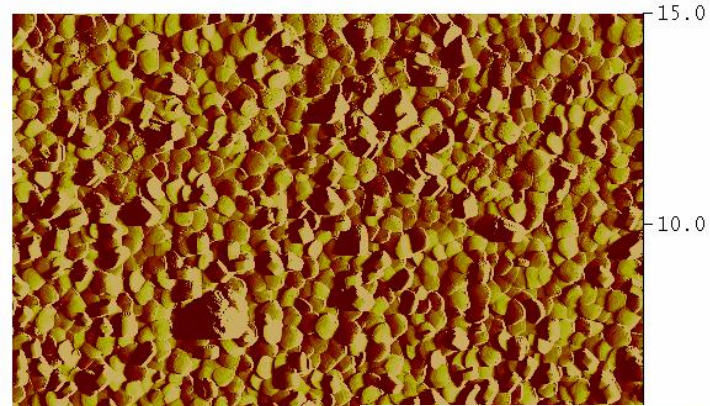


materiál hrotu a pružiny: Si, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>

# AFM v oblasti repulsivních sil: Kontaktní režim

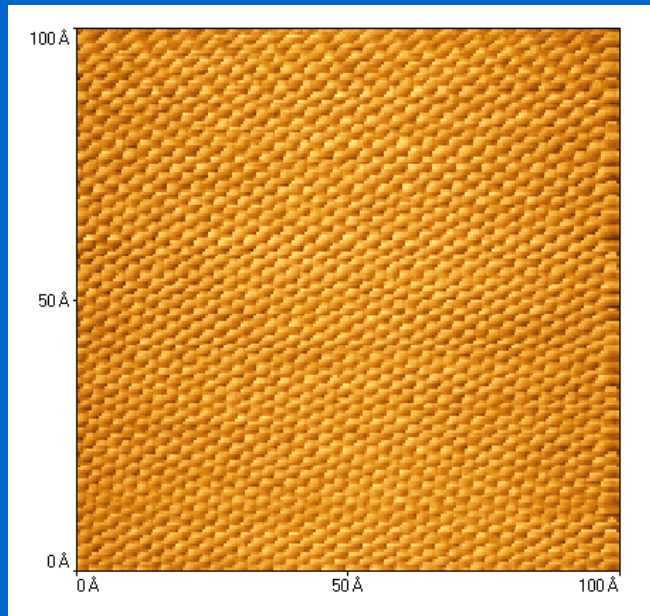


# AFM zobrazení: Kontaktní režim

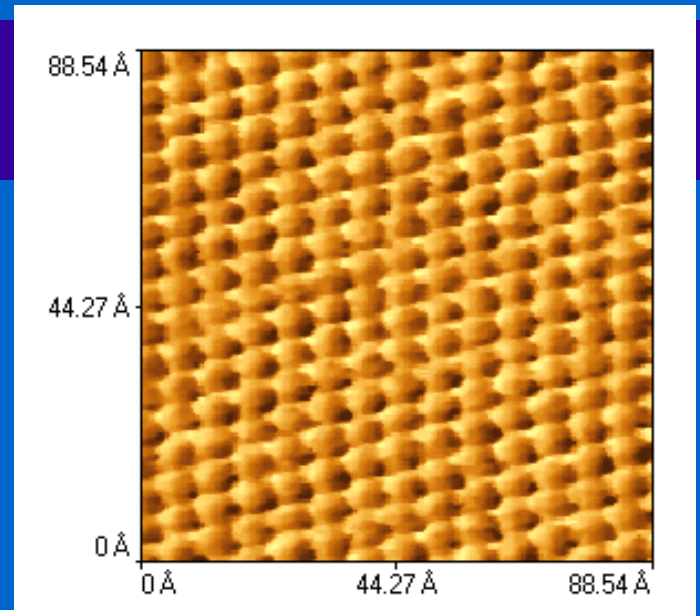


Krystaly zeolitu

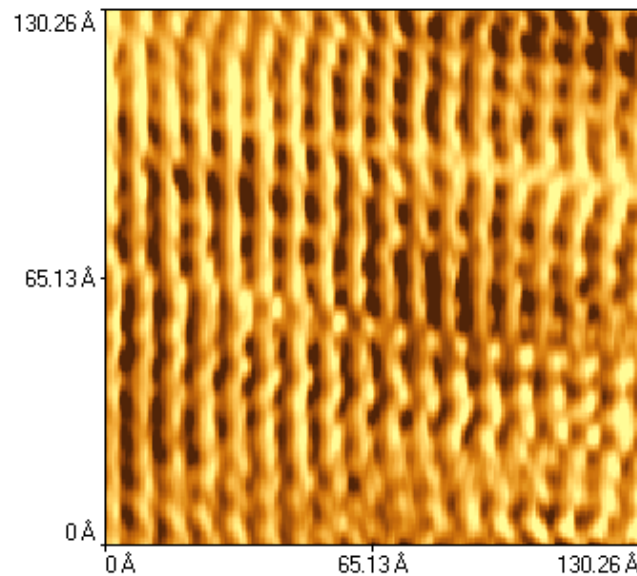
# AFM zobrazení: kontaktní režim



grafit



slída

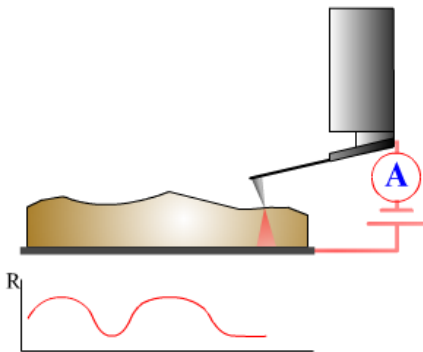


Orientované  
molekuly Teflonu

# Vodivostní AFM

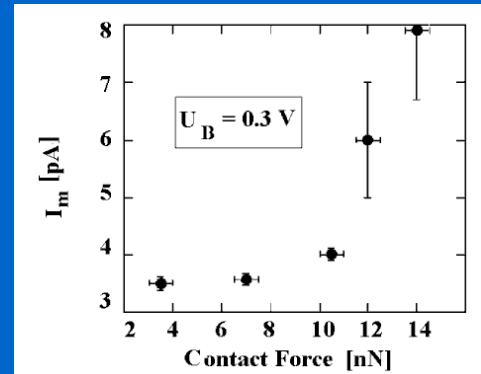
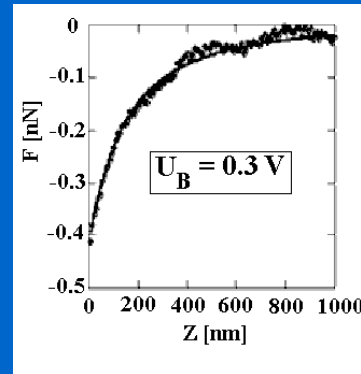
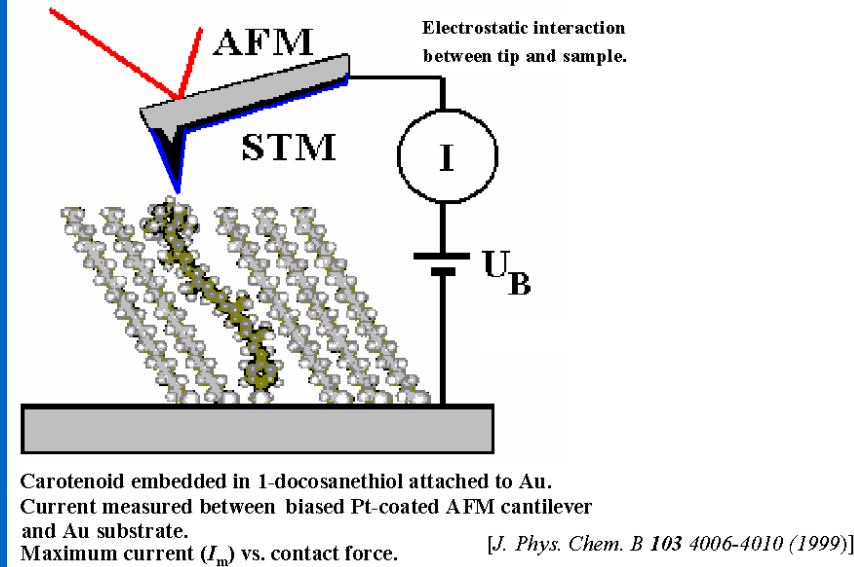
Spreading Resistance imaging

Constant Force mode

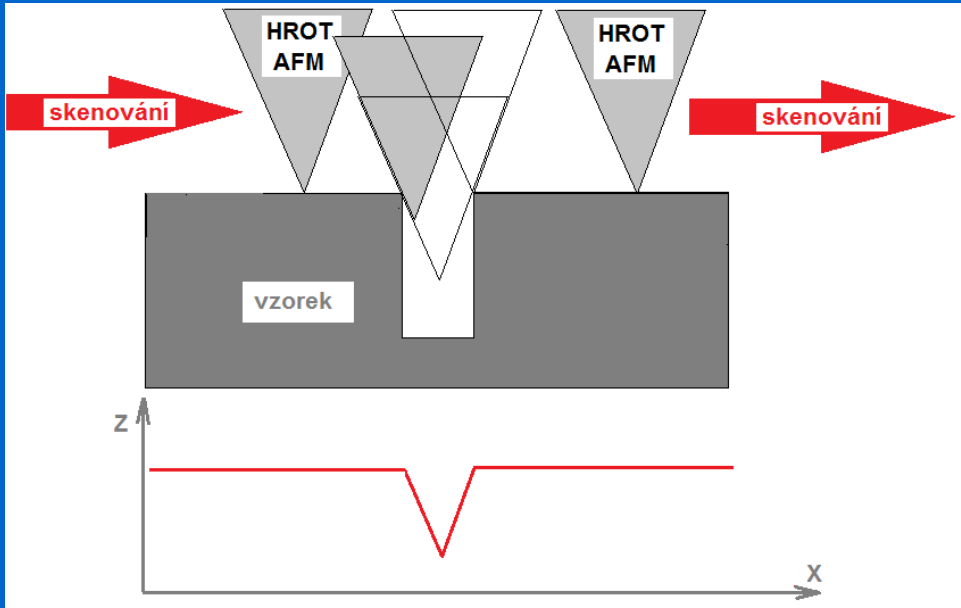
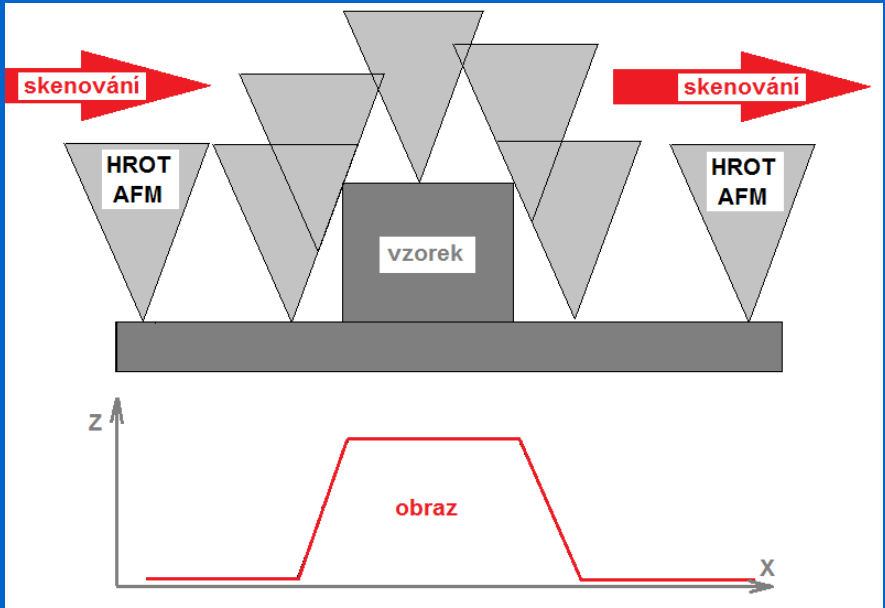


conductive tip  
(B-doped diamond, n-doped Si)

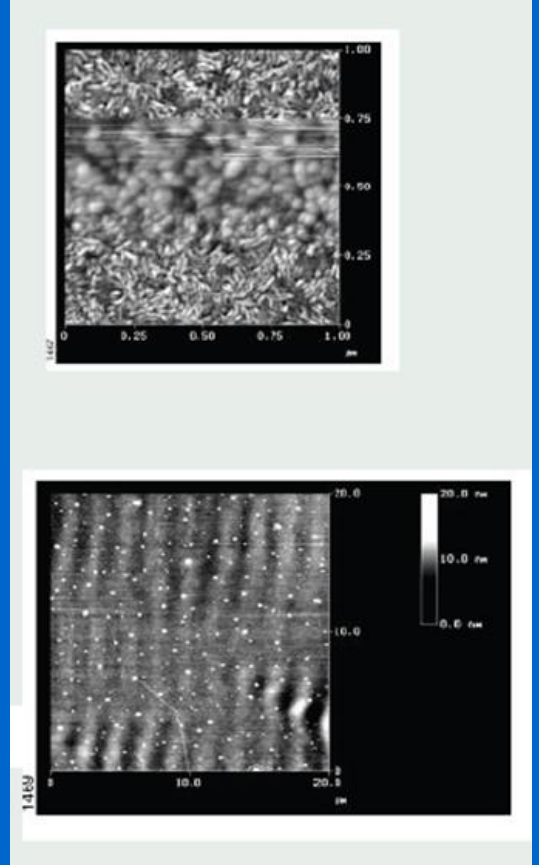
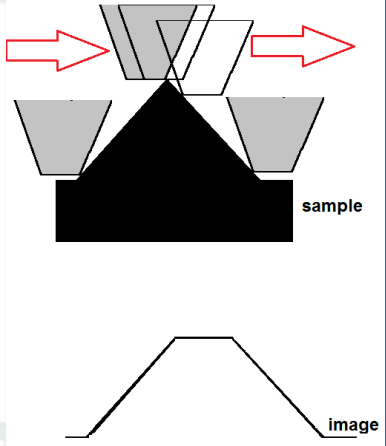
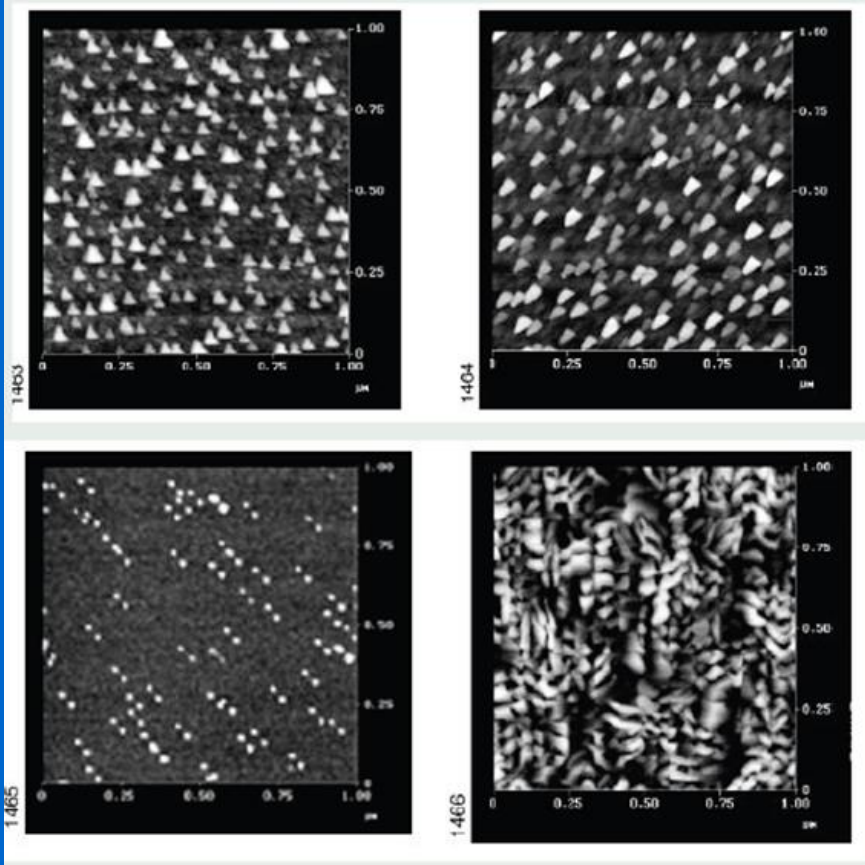
Copyright © NT-MDT, 2002



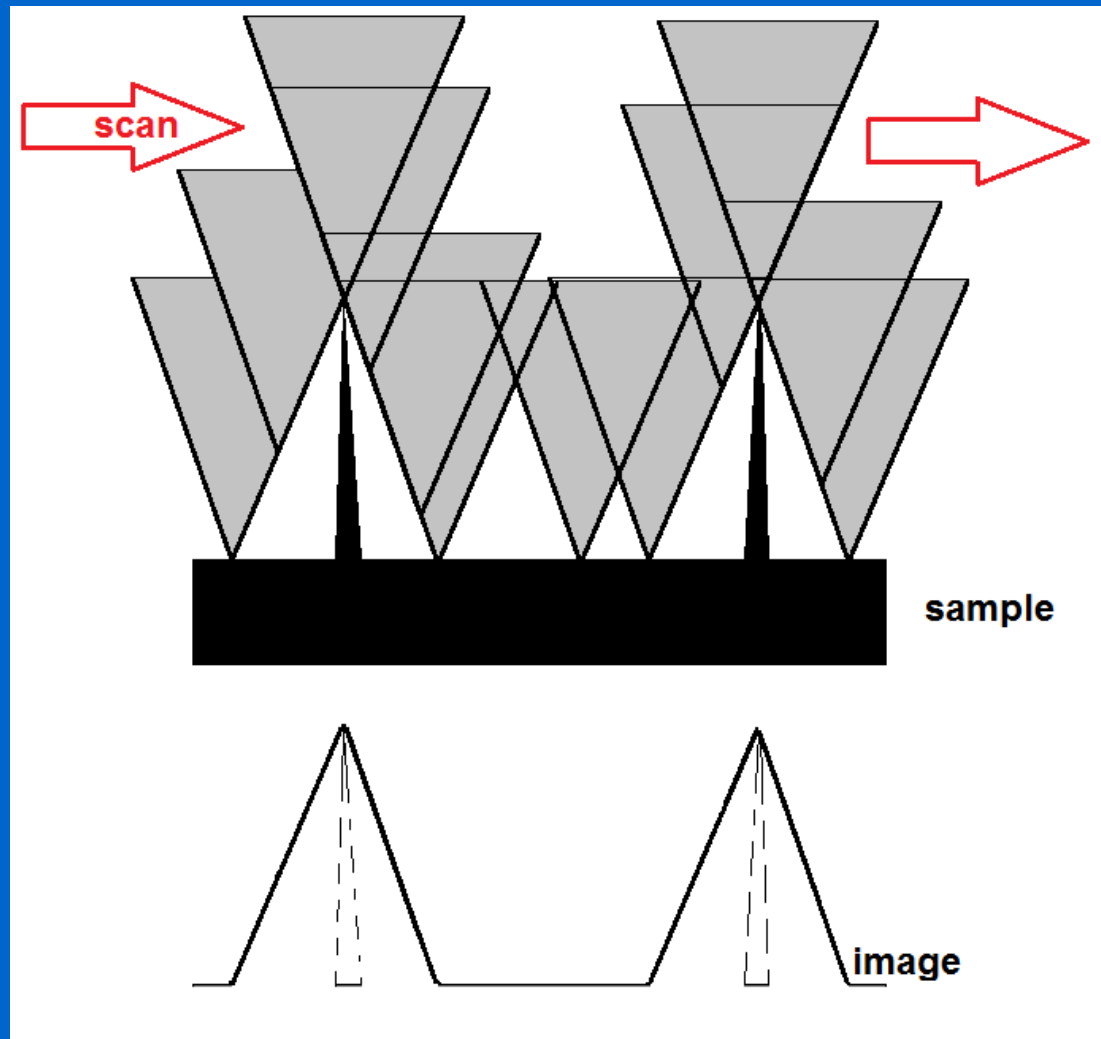
# AFM: artefakty



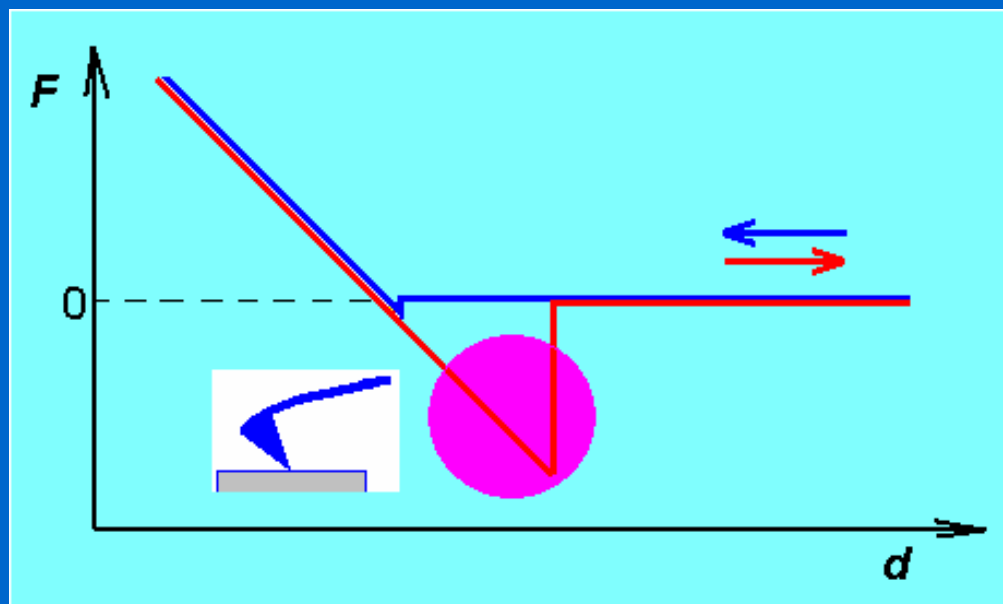
# AFM: artefakty



# zobrazení hrotu

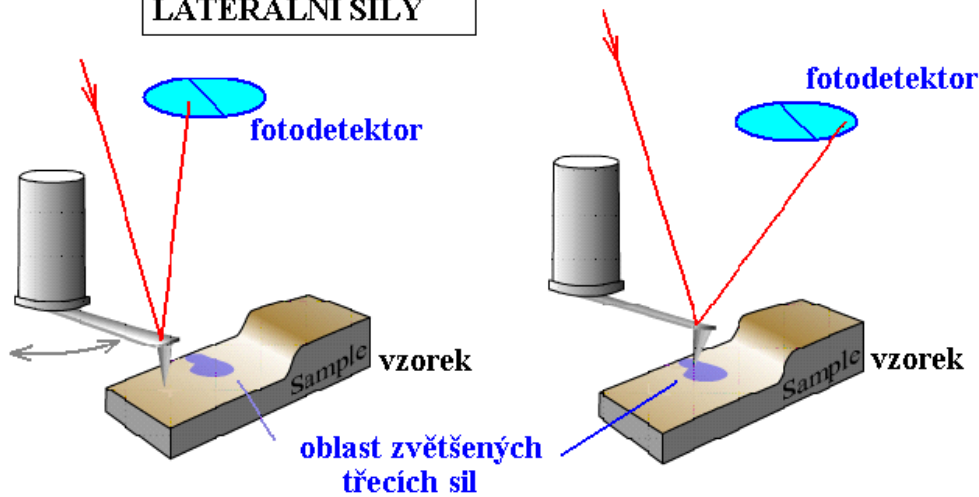


# AFM: Přitažlivé síly- adheze, vazebné interakce

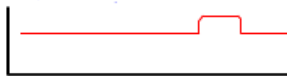


# AFM adhesivních sil: laterální (frikční) síly (LFM)

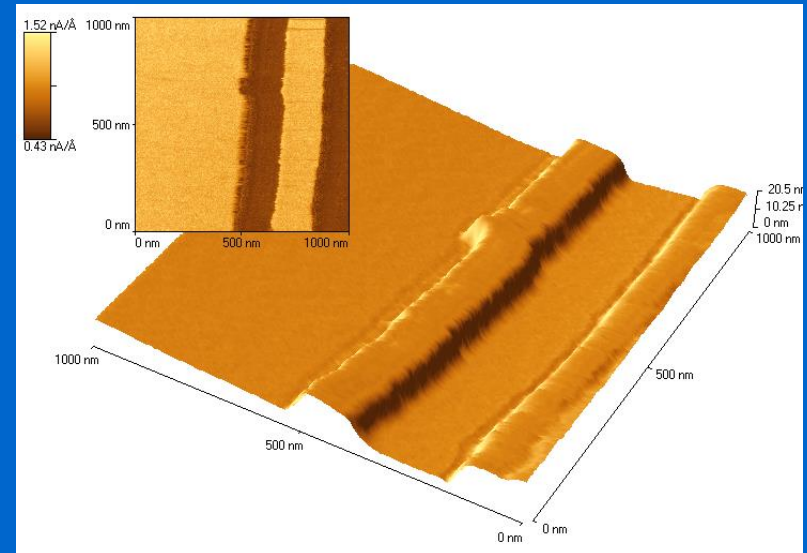
KONTAKTNÍ REŽIM  
LATERÁLNÍ SÍLY



úhel překroučení  
pružiny

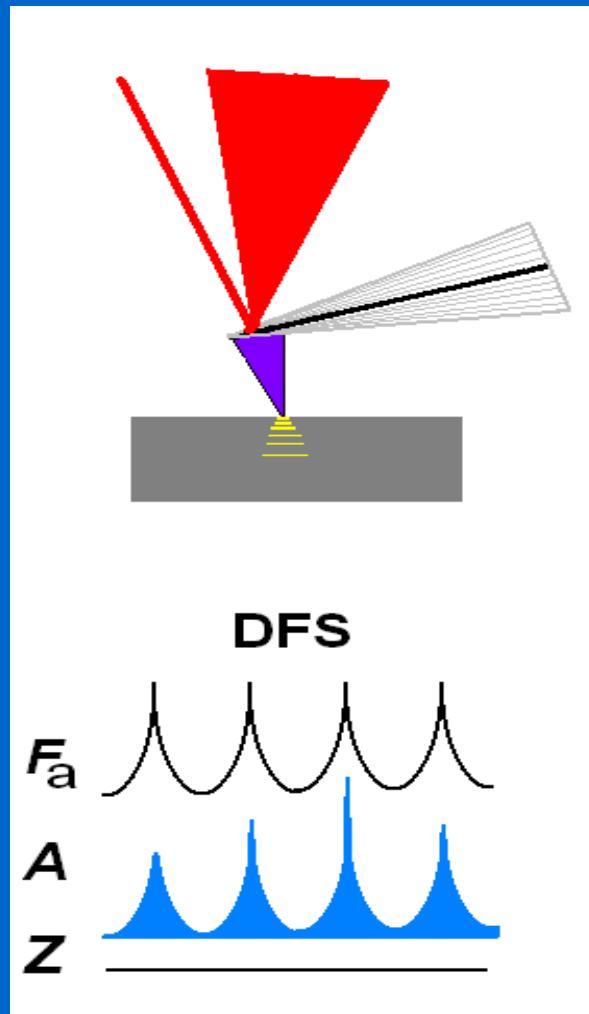


třecí síla



Teflon na skle: AFM  
-topografie  
-rozložení frikčních sil

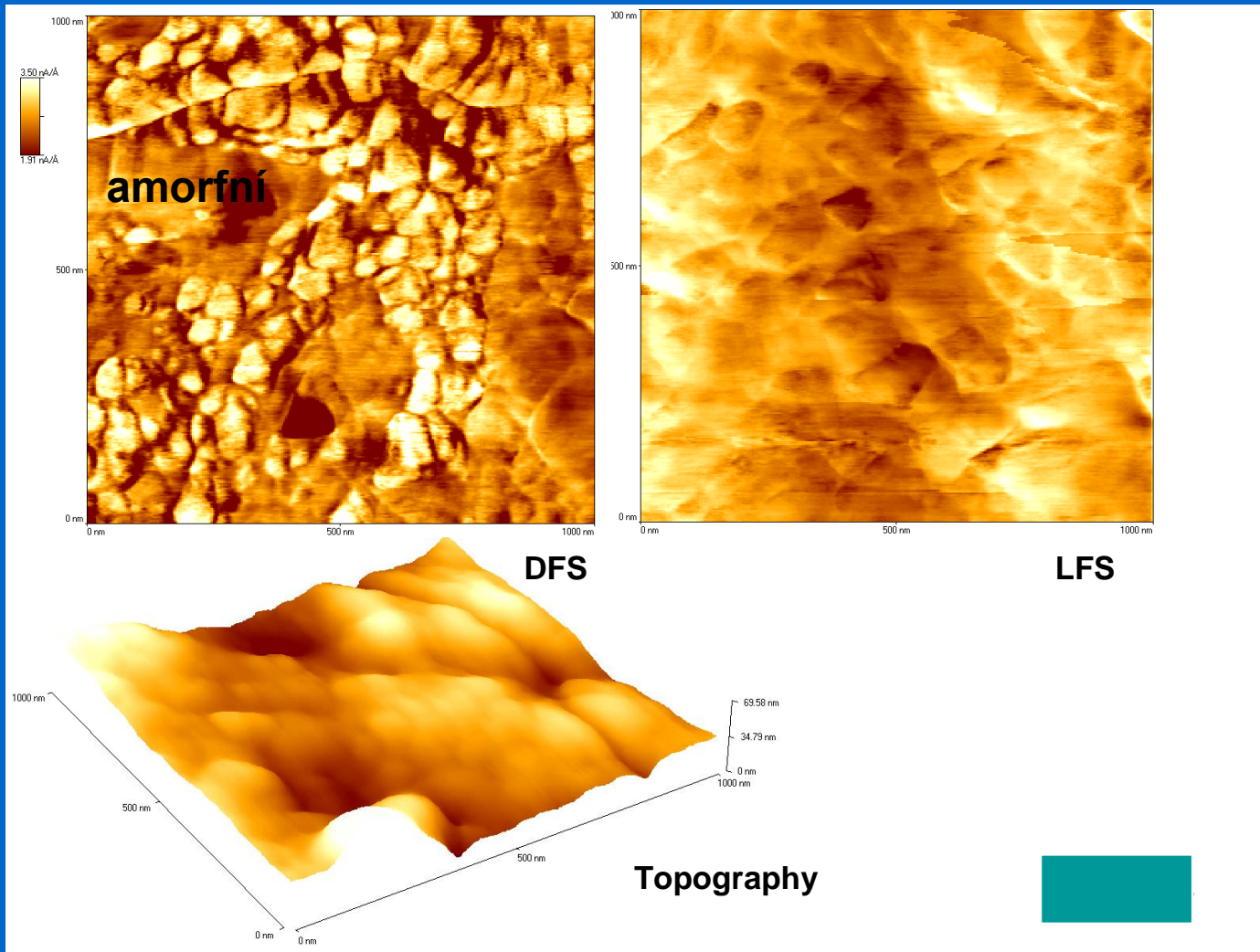
# AFM – Dynamická silová spektroskopie (DFS)



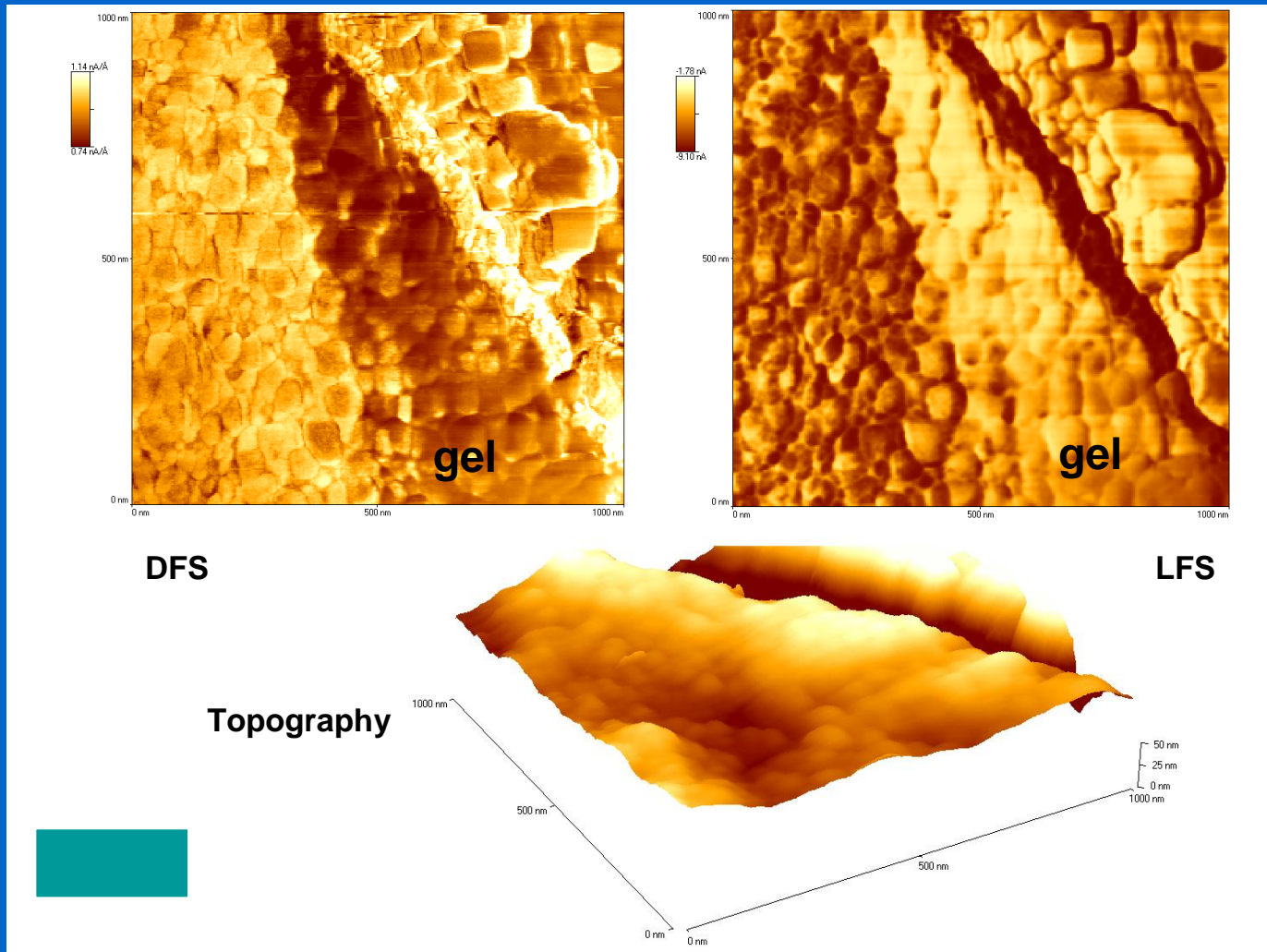
Disipace energie:  
útlum, elasticita, plasticita  
 $Y_M$

Hrot v kontaktu,  
 $f_{drive}$ ,  $A_{drive}/A_{response}$

# AFM-DFS materiálová analýza povrchu Zr/ZrO<sub>2</sub>



# AFM - DFS materiálová analýza povrchu Zr/Nb/ZrO<sub>2</sub>

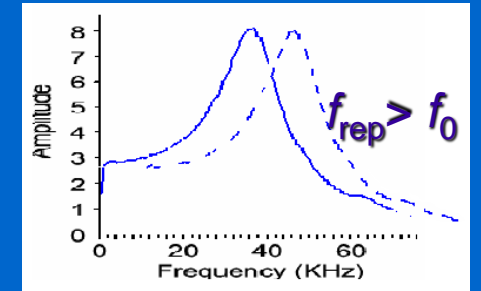
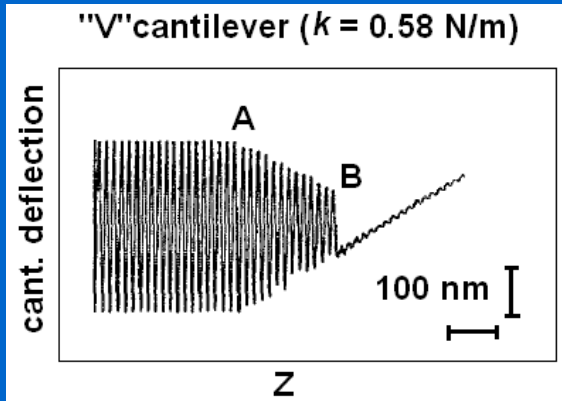
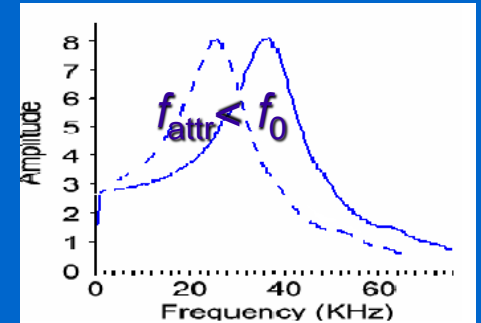
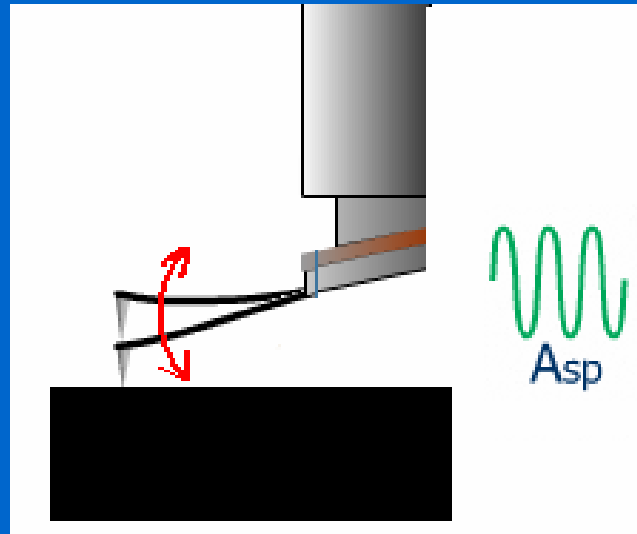


# Semikontaktní režim (tapping)

## Akustic./mgt. buzení

mechanický oscilátor  
kmitající v rezonanci  
vstupní parametry:  
 $f_{rez}$   $A_{sp}$  (~ 20 nm)

výstupní parametry  
 $A$ ,  $\Delta f_{rez}$ ,  $\Delta\theta$ ,  $d(\text{deflexe})$



$$m d^2 z / dt^2 = -kz - (m\omega_0 / Q) dz / dt + F_{ts} + F_d \cos \omega t \quad \text{piezo (drive)}$$

Hook      disipace e.      Interakce hrotu s povrchem

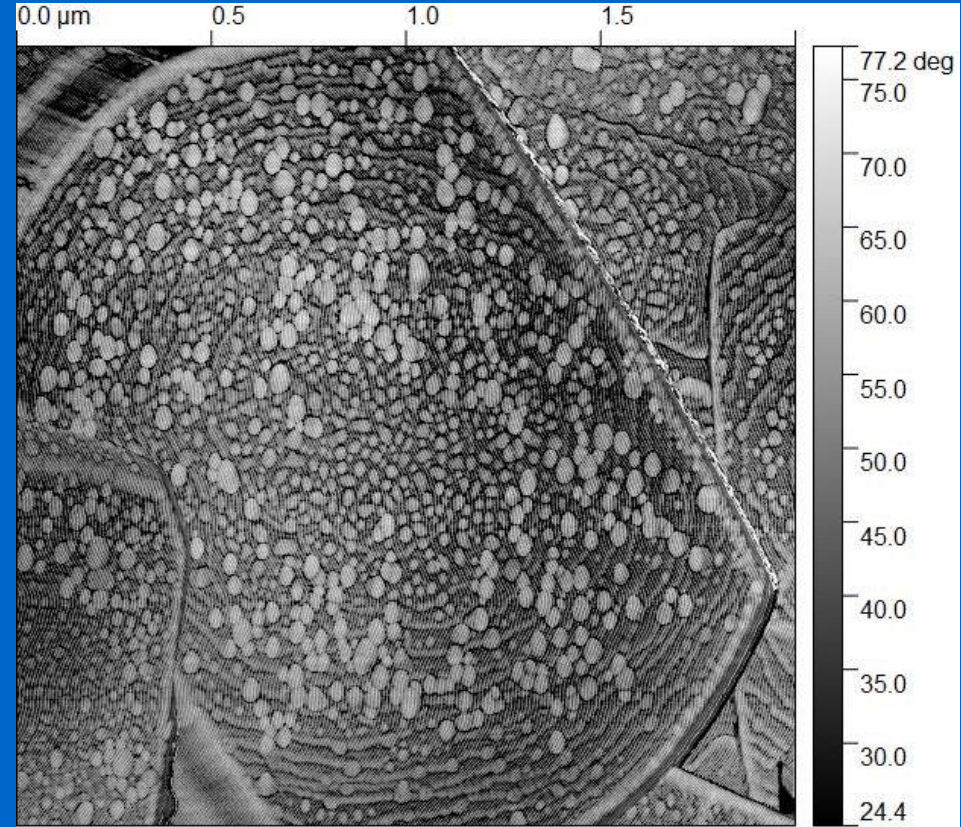
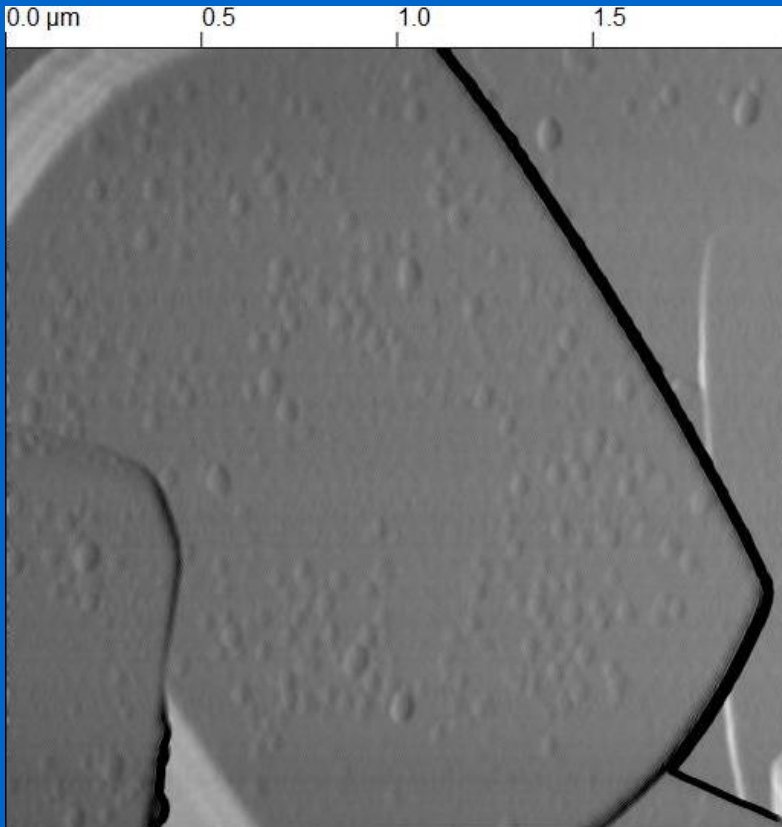
$$\omega_0 = \sqrt{k/m}$$

Fázový posun  $\sim E_{\text{dis}}$

# Semikontaktní režim

(tapping: amplituda x fáze)

$$\sin \phi = \frac{A}{A_0} \left( 1 + \frac{E_{\text{dis}}}{E_{\text{med}}} \right)$$



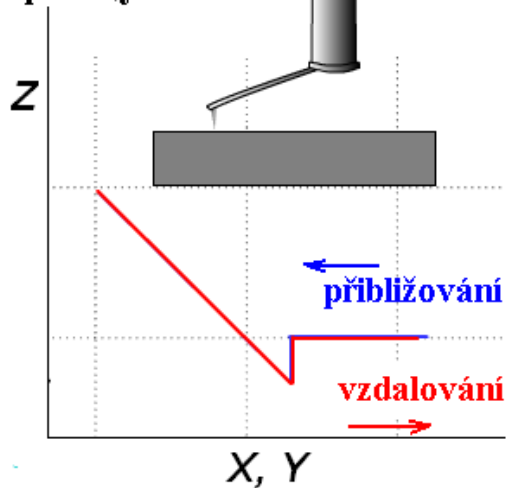
Amplituda

-

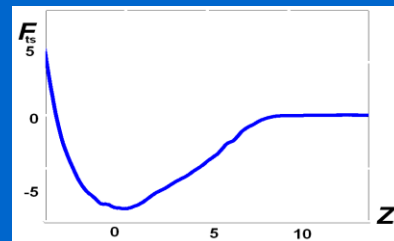
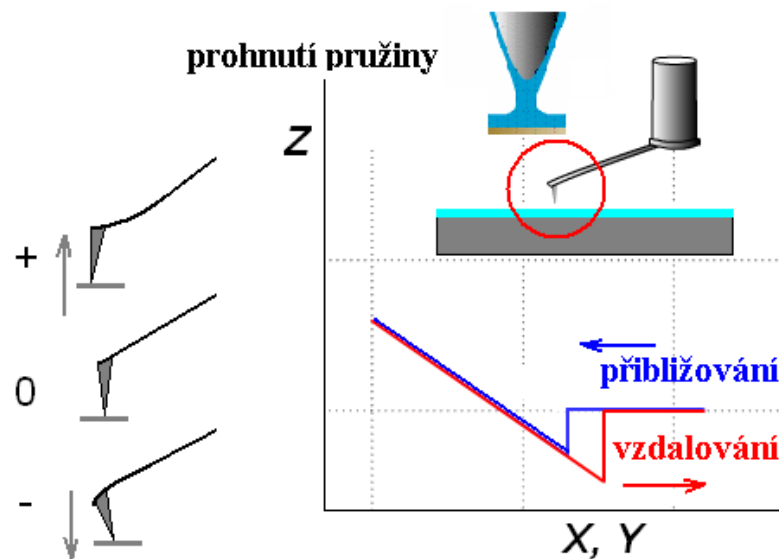
fáze

# AFM adhesivních (axiálních) sil

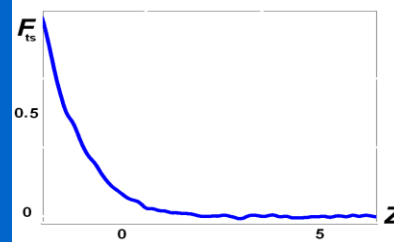
prohnutí pružiny



prohnutí pružiny

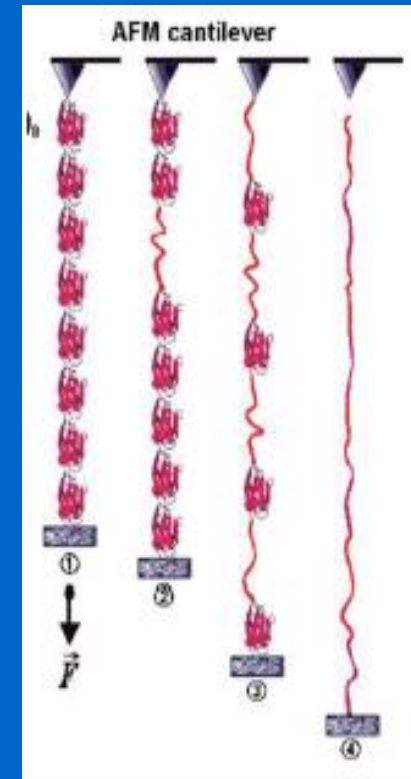
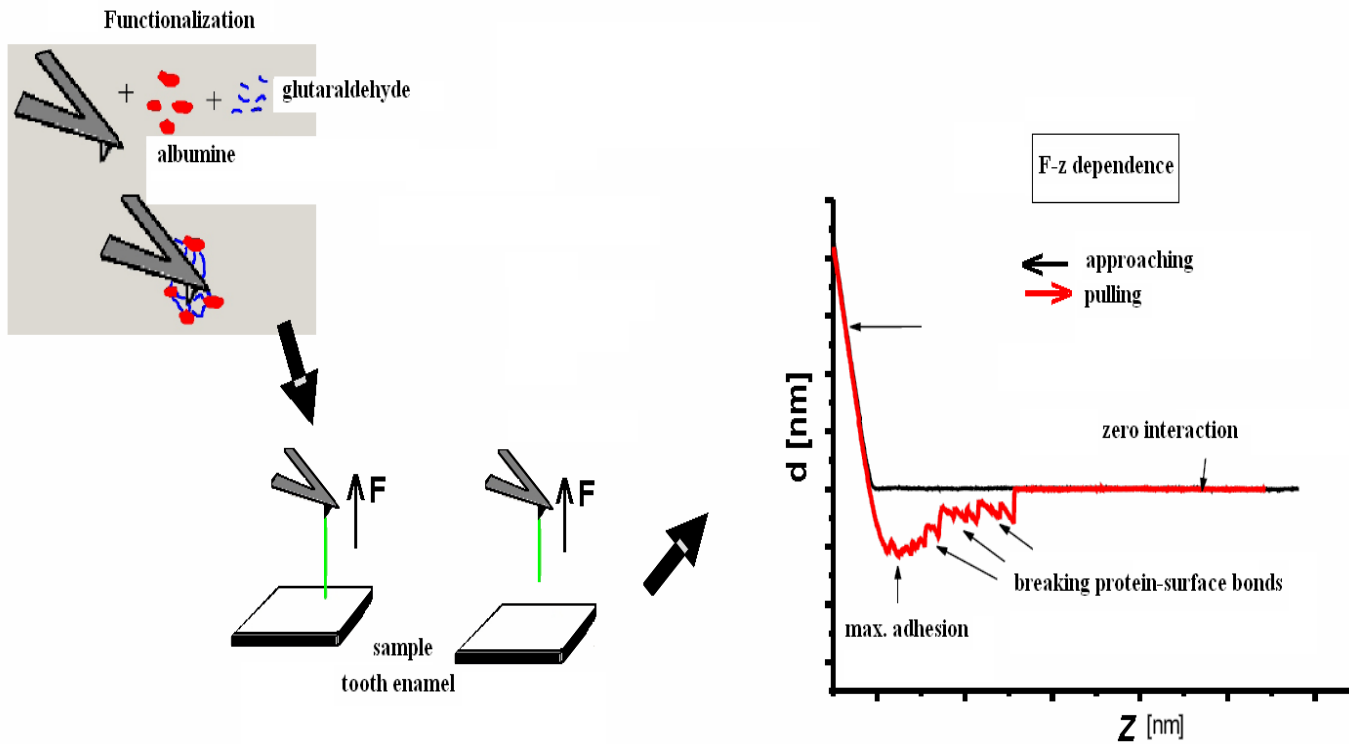


$F_{ts}(Z)$   
(Si/SiO<sub>2</sub>)/vzduch



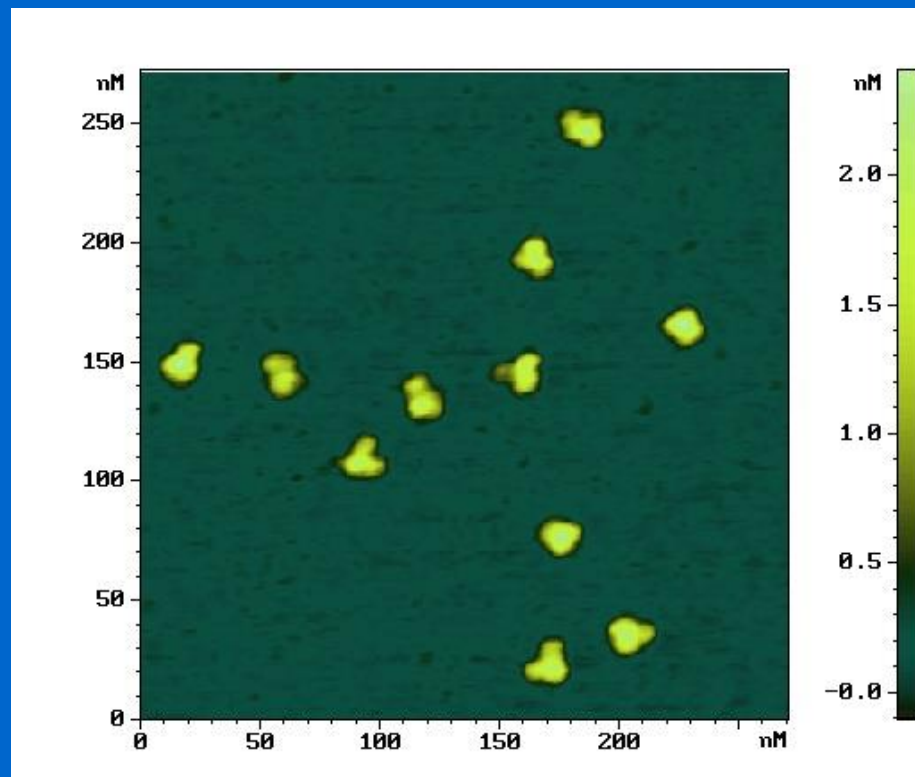
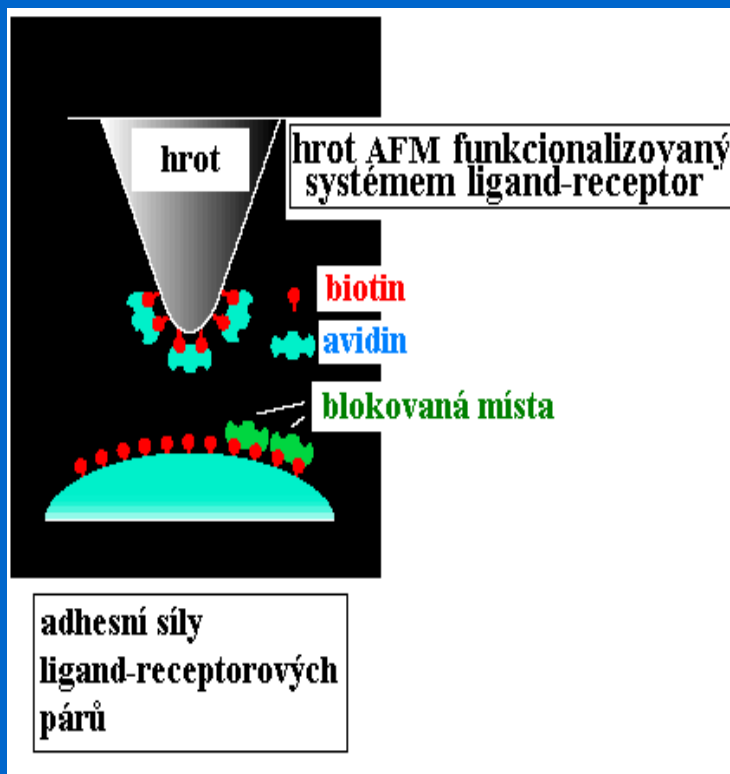
*in situ* (voda)

# Adsorpce proteinů na zubní sklovině



N. Schwender , M. Mondon , K. Huber , M. Hannig , C. Ziegler Department of Physics, University of Kaiserslautern,  
Department of Operative Dentistry and Periodontology, Saarland University

# AFM s modifikovaným hrotem semikontaktní režim (tapping): vazebné interakce



Monoklonální antigen 1RK2 k A-řetězci ricinu (hrot-IgG1).  
Viditelná je Y-struktura antigenu.

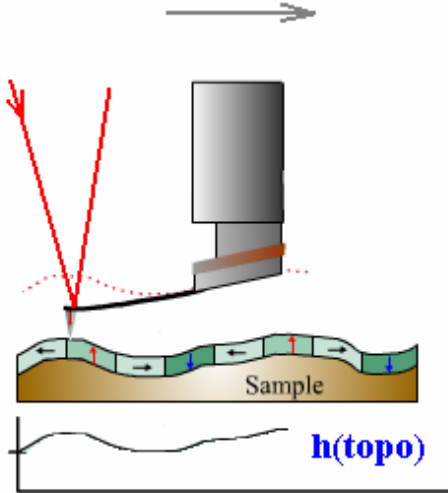
[Bruker]

- 
- 
- 

# AFM: bezkontaktní režim

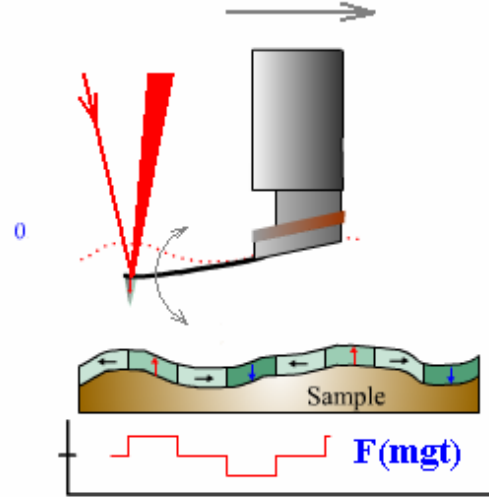
# Bezkontaktní AFM: Mikroskopie magnetických sil Magnetic Force Microscopy

1. topography



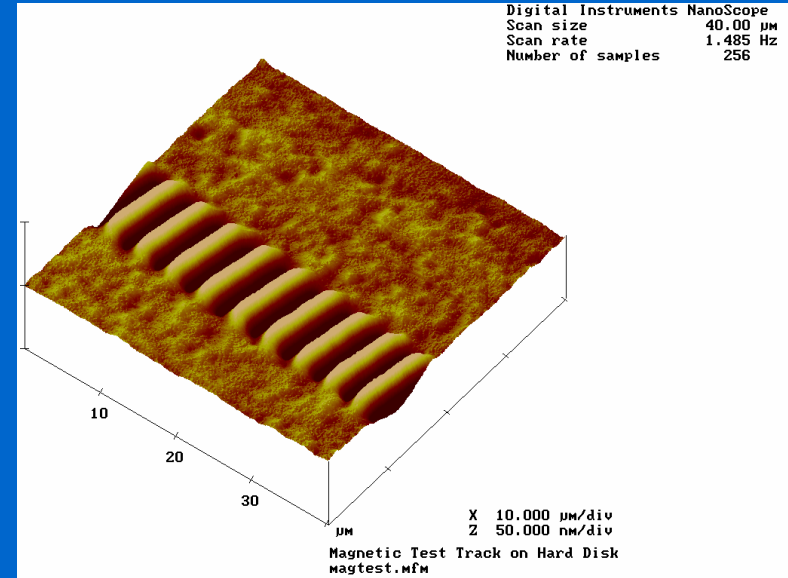
van der Waals. forces  
(semicontact)

2. mag. forces



noncontact imaging

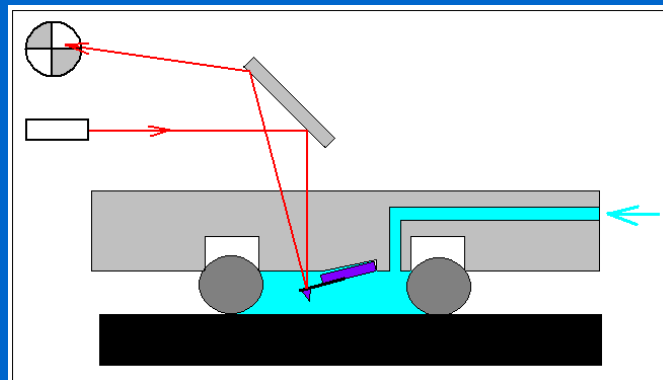
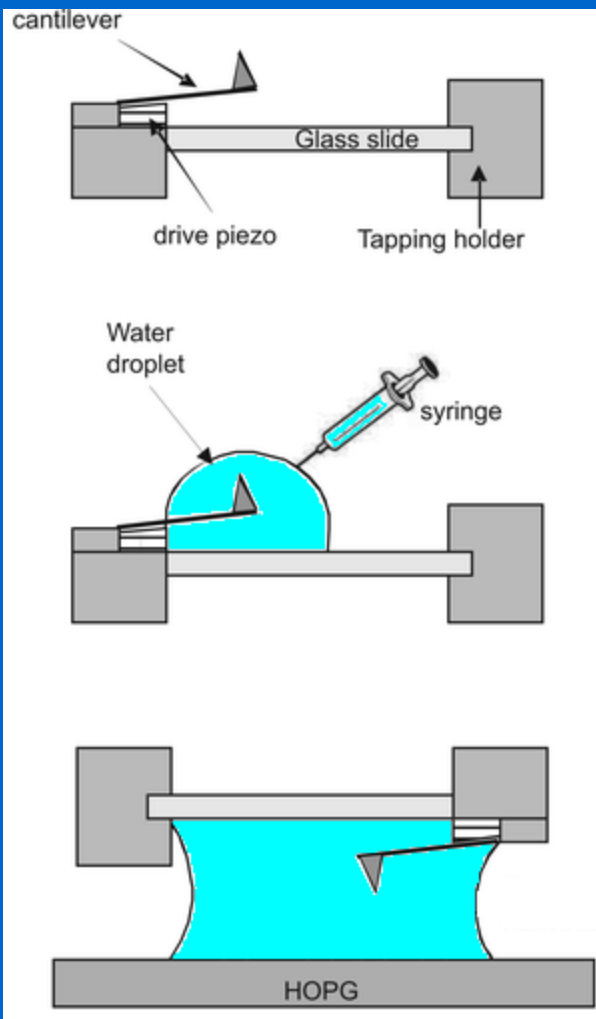
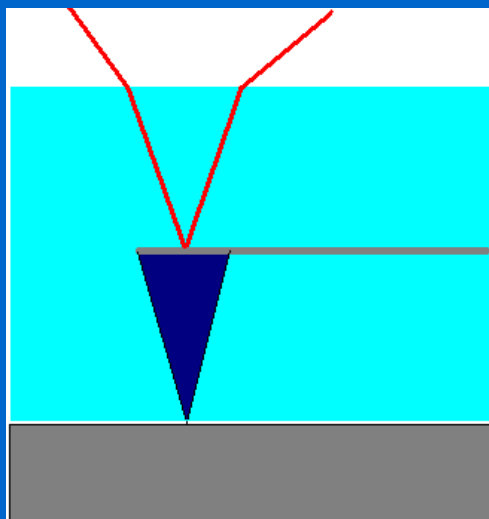
NT-MDT



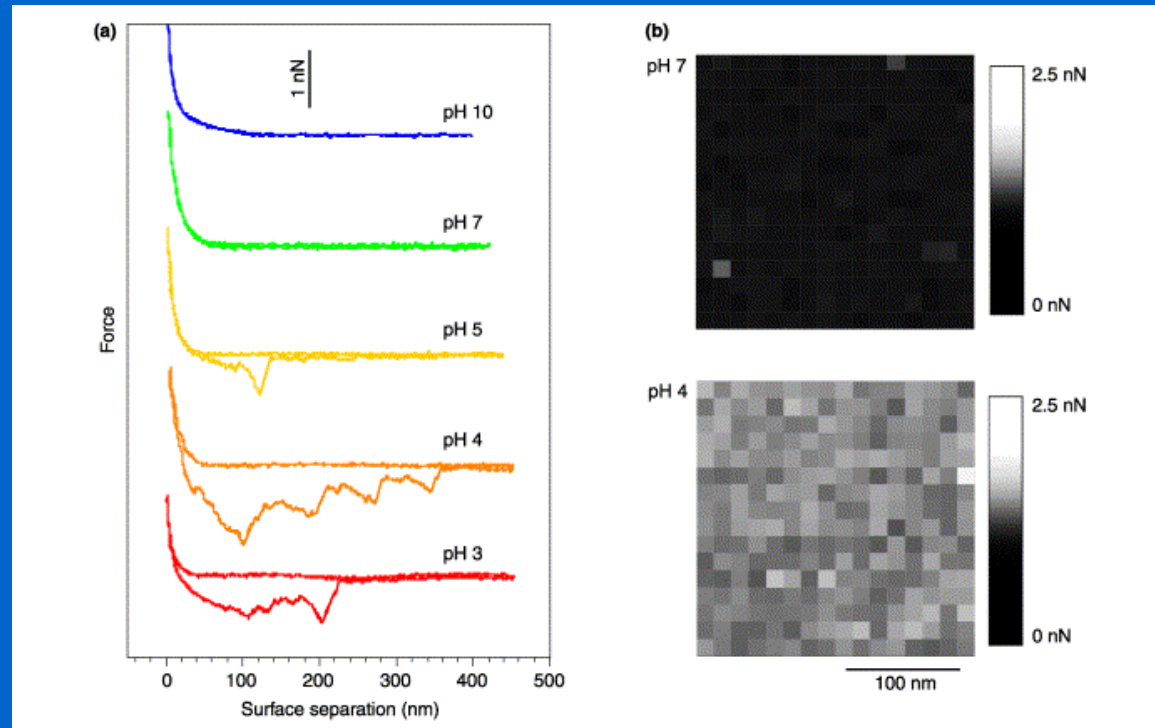
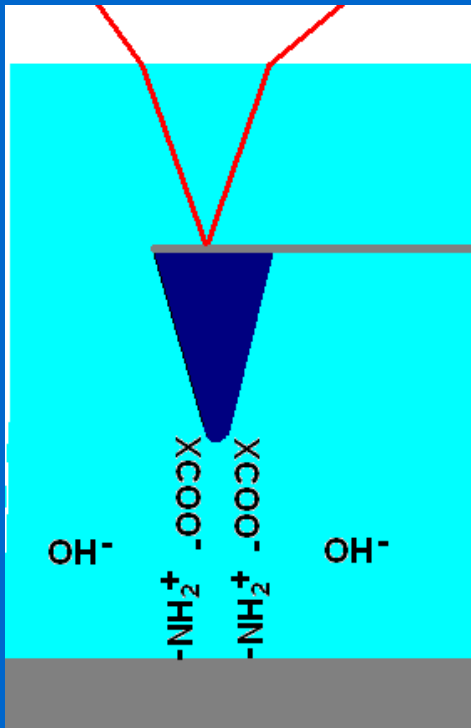
- 
- 
- 

# Mikroskopie atomárních sil (AFM) v kapalinách

# AFM v kapalině

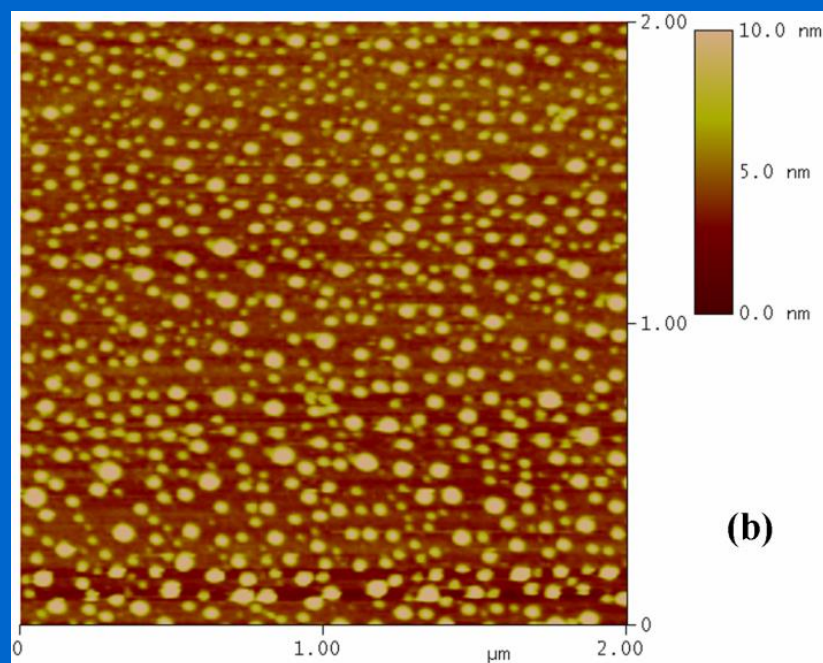
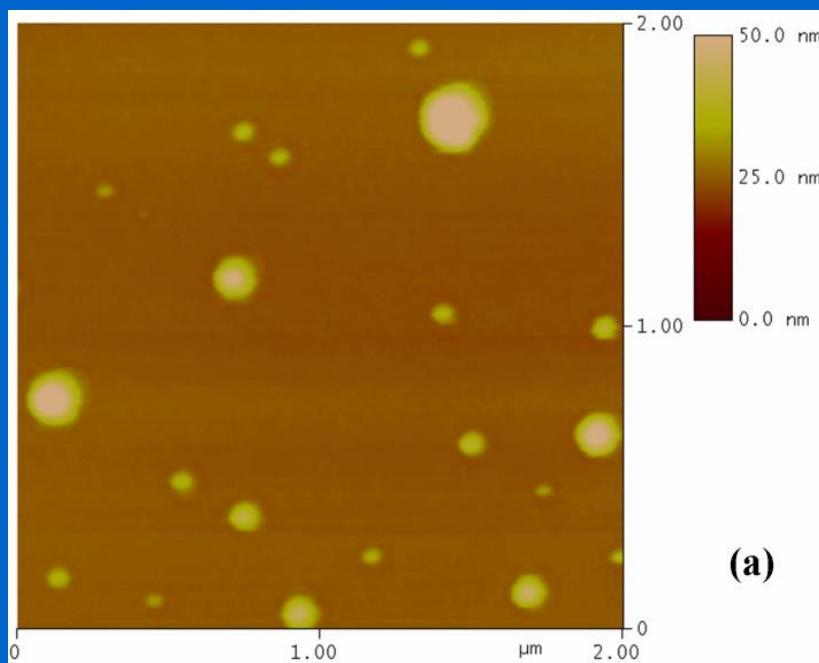


# AFM adhesivních sil - axiální (semikontaktní režim *in situ*)



„Break-up“ adhesivní síly na povrchu buněčné membrány  
*Saccharomyces cerevisiae* při změně pH

# Nanobubliny na mezifázi kapalina/pevná látka

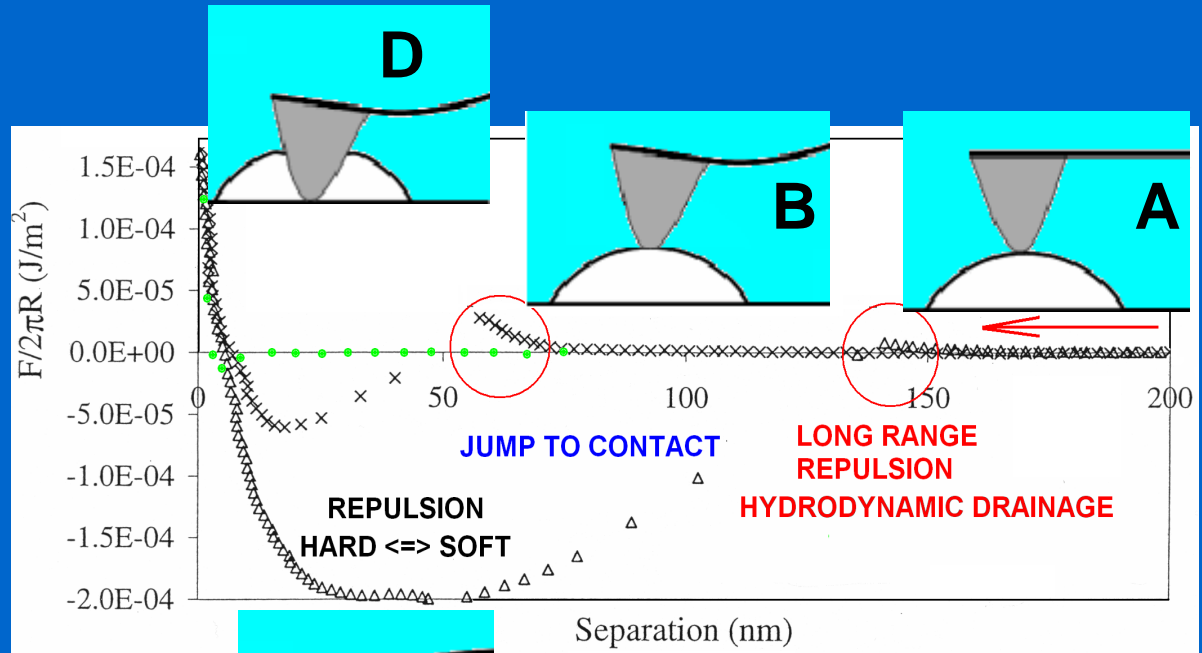
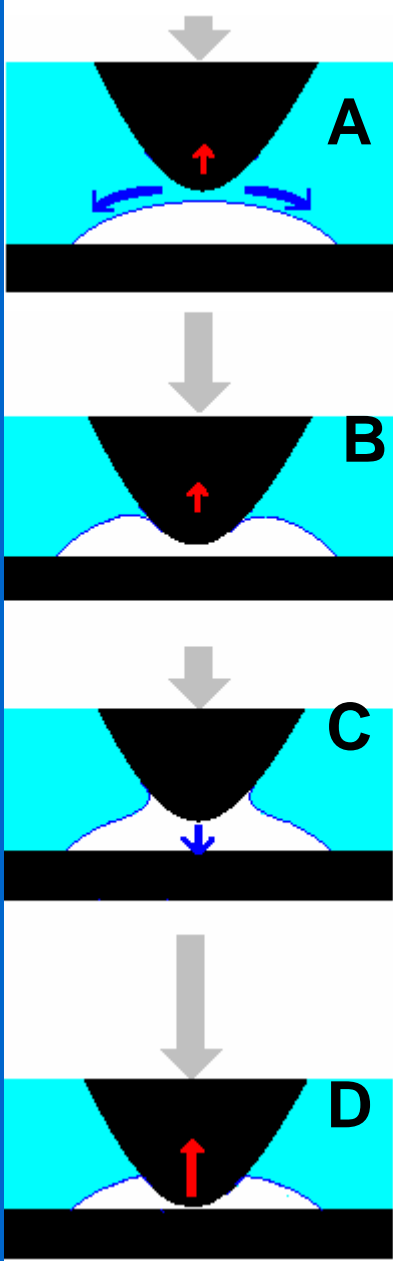


5 %

pokrytí

30 %

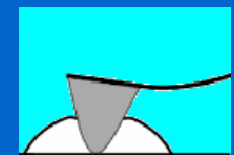
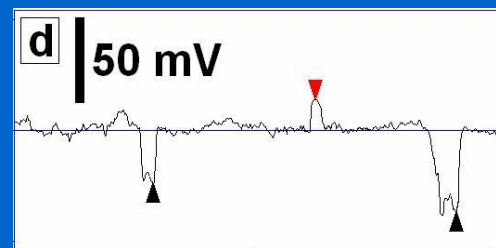
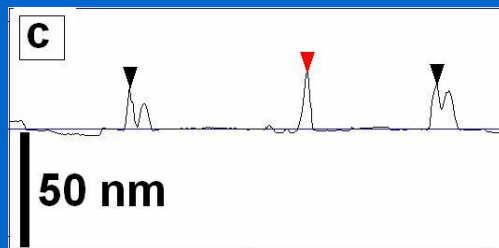
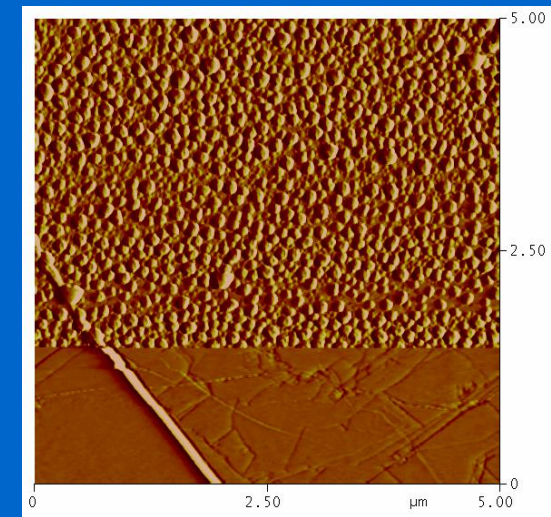
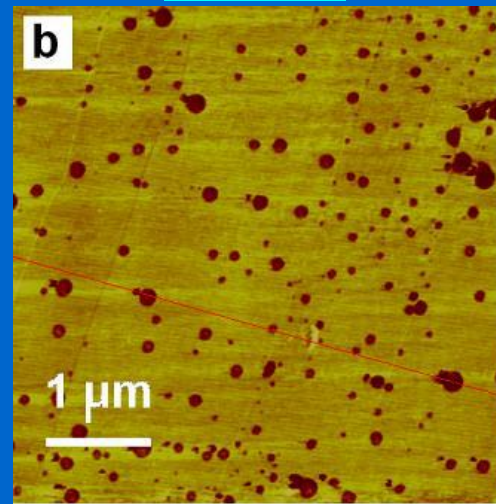
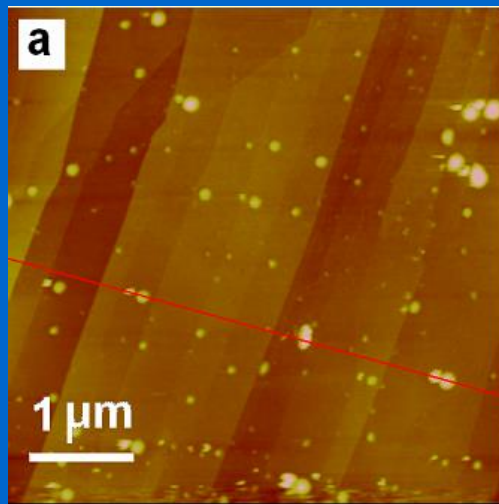
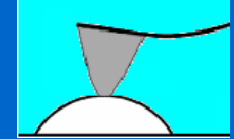
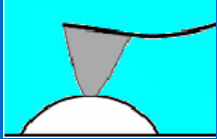
# Nanobubliny na mezifází kapalina/pevná látka



AFM silová křivka

[A. Carambassis, L. C. Jonker, P. Attard, and M. W. Rutland, *Phys. Rev. Lett.* 80, 5357-5360 (1998)]  
 [Holmberg et al.: *Langmuir*, Vol. 19, No. 25, 2003]

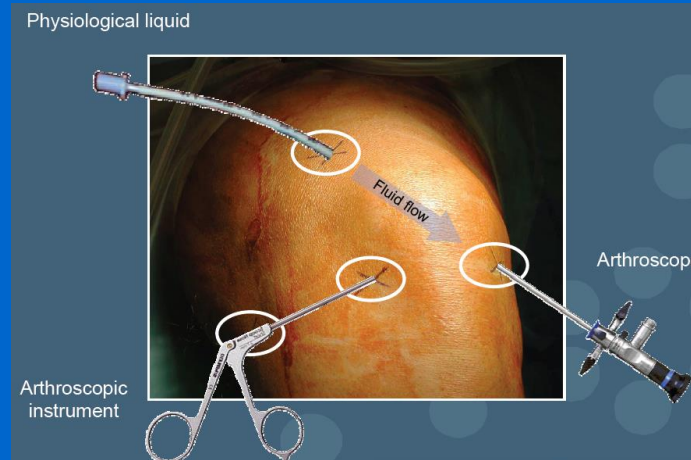
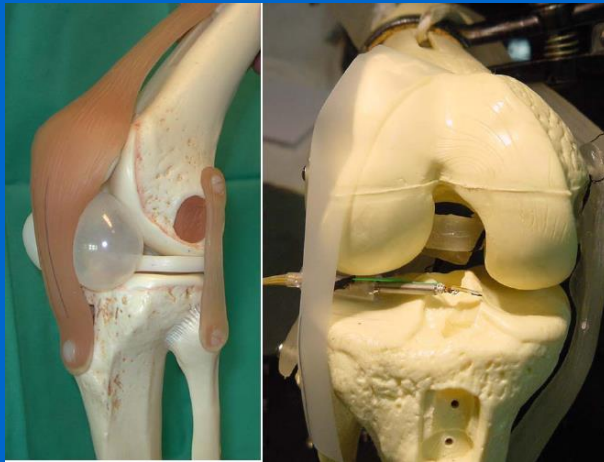
# Nanobubliny na mezifázi kapalina/pevná látka



**Topografie**

**Prohnutí cantileveru**

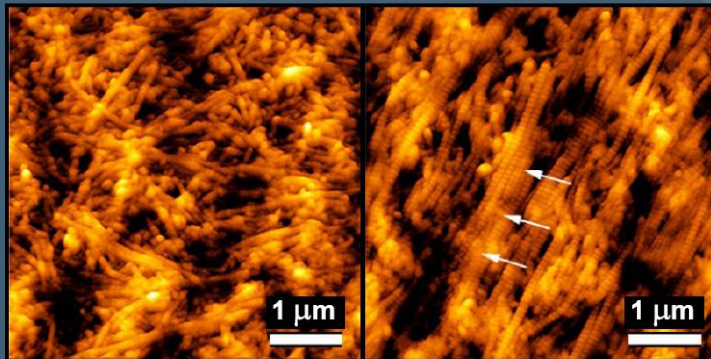
# AFM *in vivo*: Scanning Force Endoscope



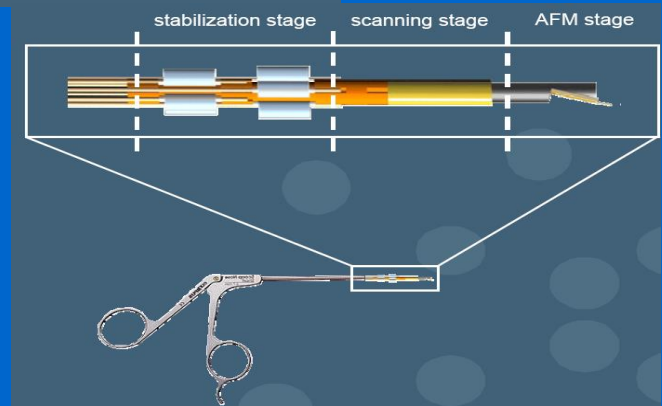
Diagnosing cartilage diseases at an early stage

healthy

osteoarthritic



M. Stolz *et al.*, *Biophys. J.* 2004; 86 3269-3283



Institute of Microtechnology  
University of Neuchâtel

R. Imer  
T. Akiyama  
N.F. de Rooij  
U. Staufer

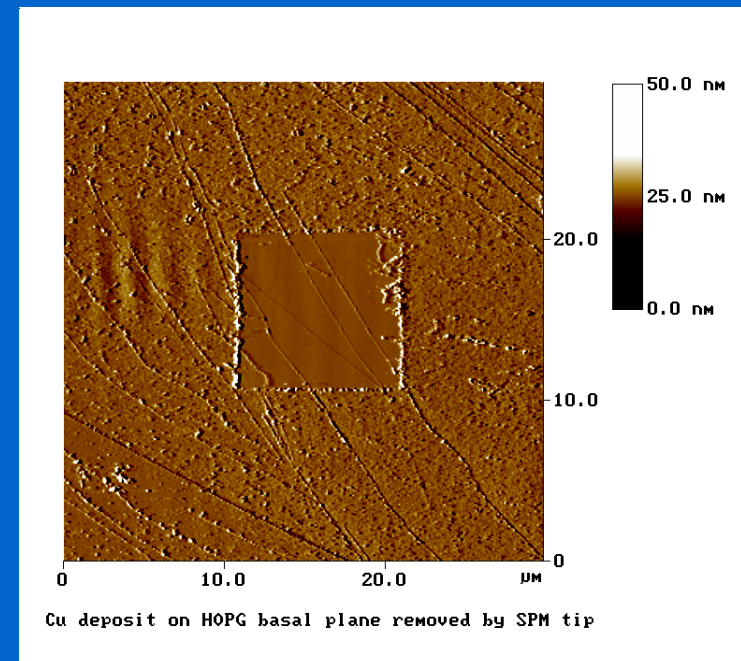
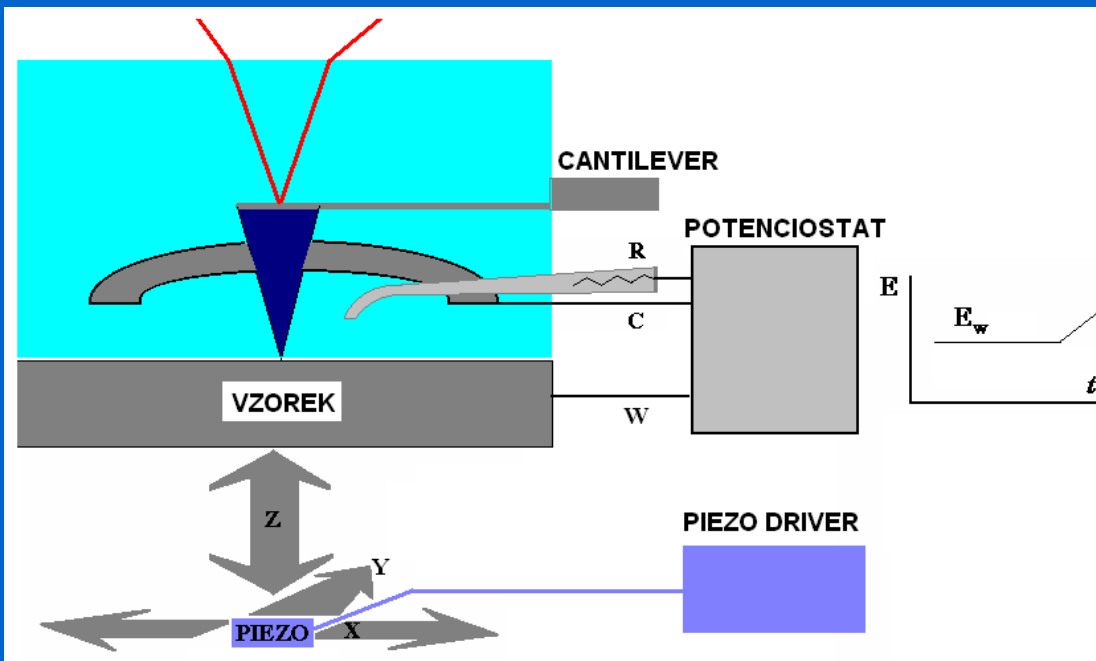
M.E. Müller Institute (MSB)  
University of Basel

M. Stolz  
U. Aebi

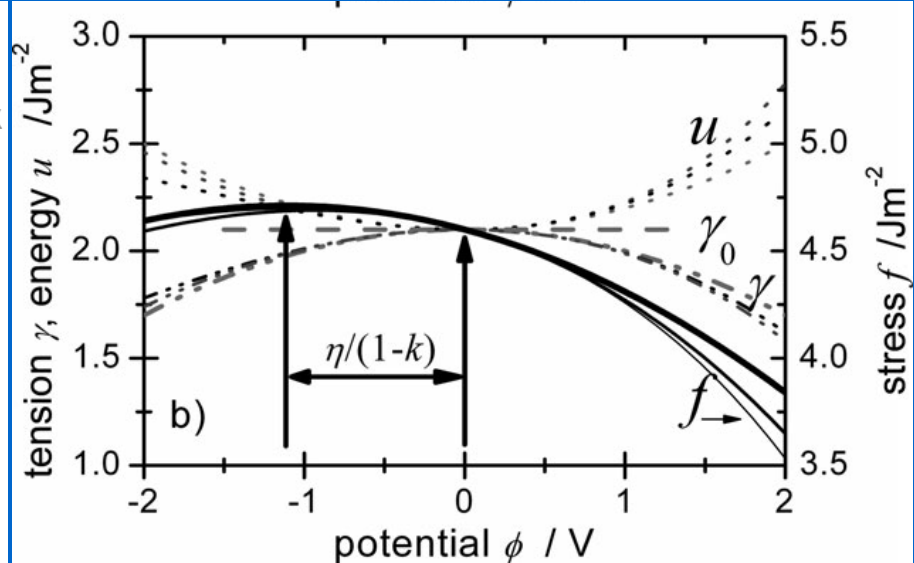
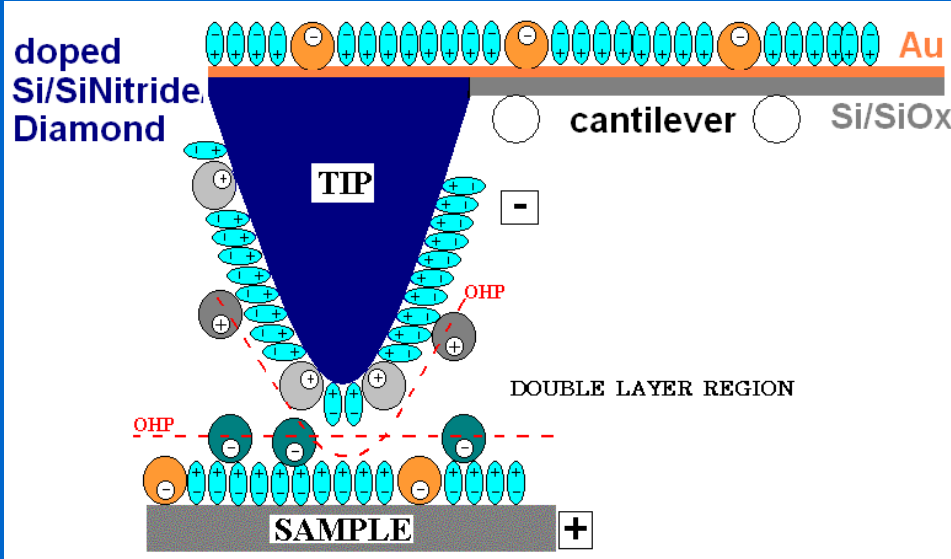
- 
- 
- 

# AFM v elektrochemických aplikacích

# AFM v průběhu EC experimentu: zobrazení *in situ*



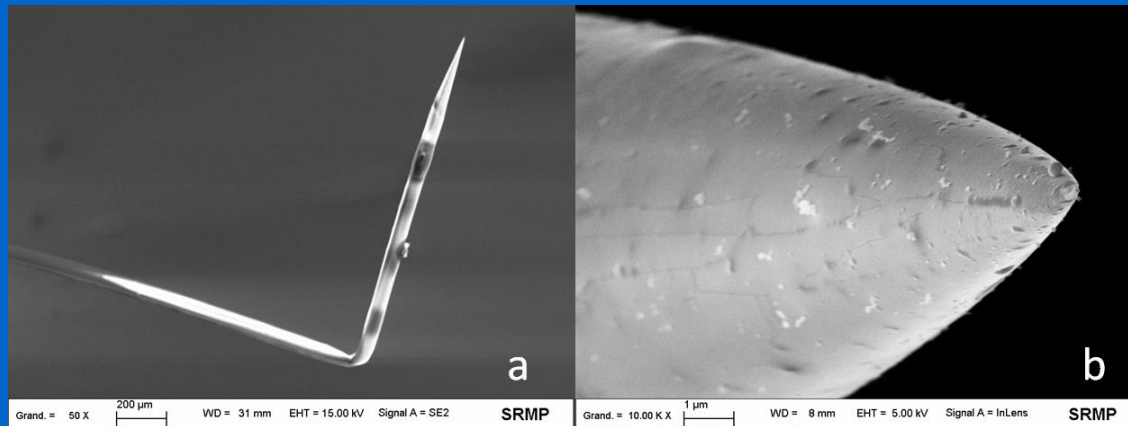
# Hrot-cantilever v režimu SECM



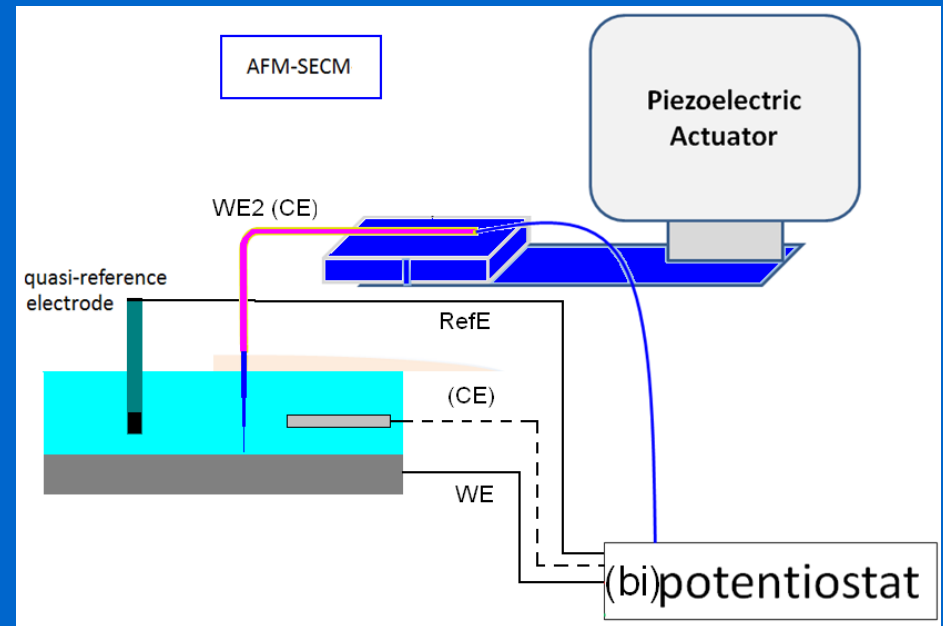
Dependence of surface tension  $\gamma$ , surface stress  $f$  and surface energy  $u$  on the electrode potential  $\phi$  ( $\phi = E - E_0$  (zero charge)), calculated for different double layer capacities.

**Lippmann:**  $dy/dE = -q$ ,  $q = C_0(E - E_0)$ ,  
 $\gamma - \gamma_0 = 0.5q^2/C_0(E_0 \dots \text{pzc})$

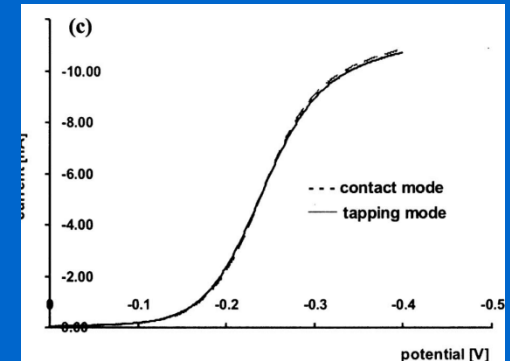
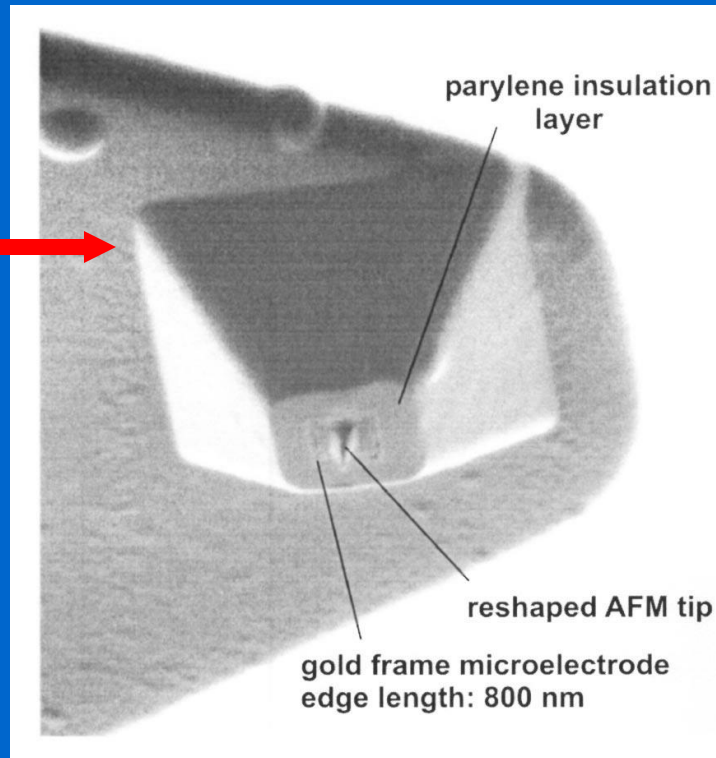
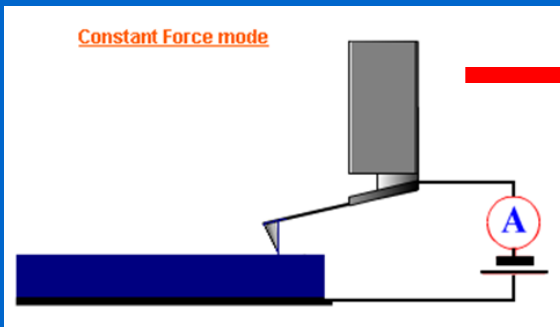
# AFM-SECM v objemu



AFM-SECM-elektroda  
izolovaná elektroforetickým  
lakem, hrot R ~130 nm



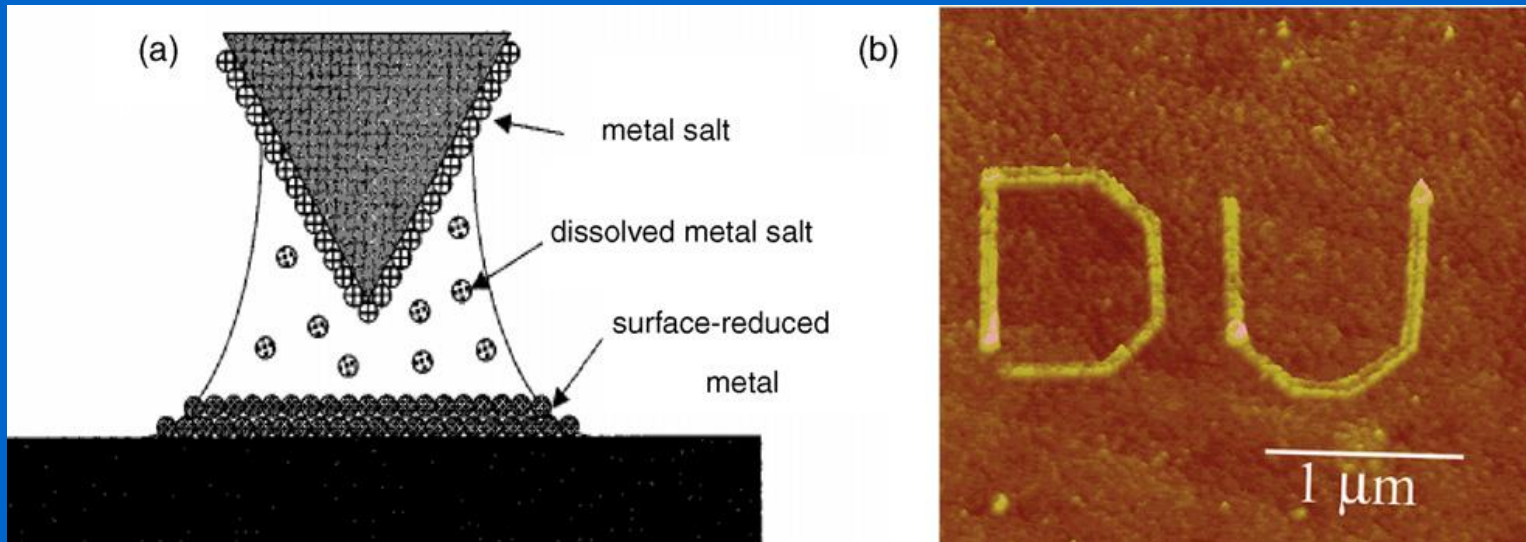
# Vodivý hrot AFM-ECM pro práci v tenké vrstvě kapalin



Cantilever with 100 nm Au insulated with 700 nm Parylene.  
LSV: SECM-AFM tip in 10 mM Ru(NH<sub>3</sub>)/0.5 M KCl soln; 100 mV/s.  
---LSV at contact mode  
— LSV at tapping

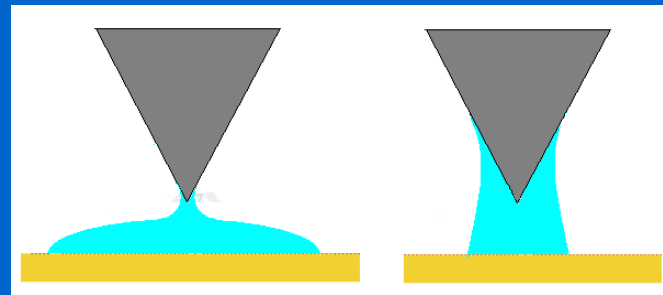
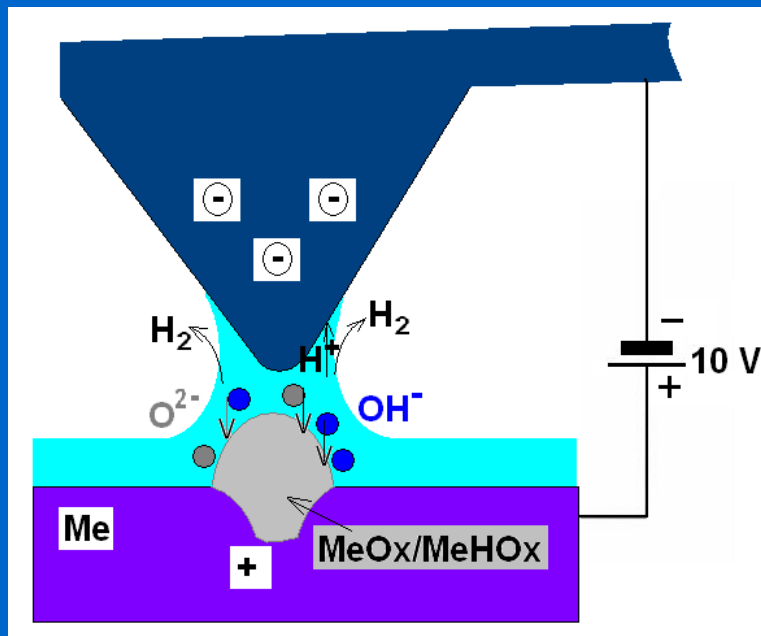
integrovaná sub-mikroelektroda  
h = 300 nm

# ECAF: hrotem zprostředkovaná elektrodepozice kovu (nano-vrstva) v kapce



Au elektrodepozice konverzí  $\text{Au(III)}$  (inkoust)  $\Rightarrow$   $\text{Au(0)}$   
2-elektrodový systém

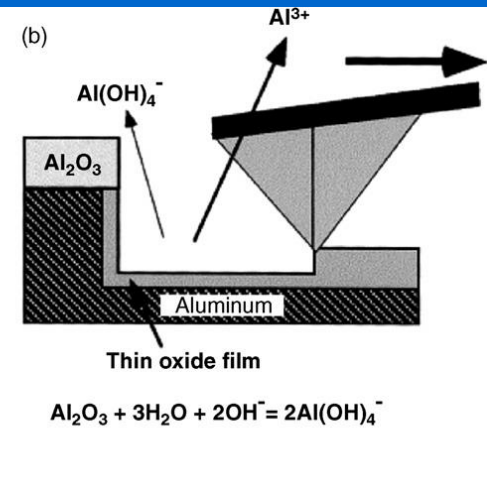
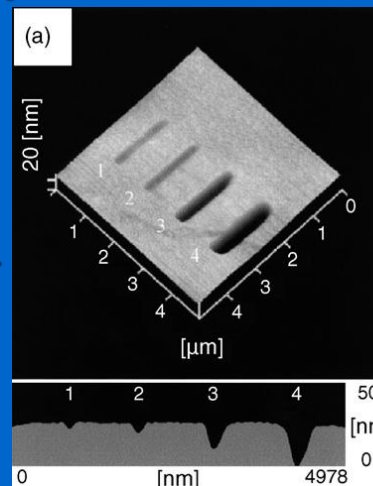
# ECAFM: hrotem indukované elektrochemické vytváření/rozpuštění oxidu (nano-vrstvy)



Formování vodního menisku na hydrofilním a hydrofobním substrátu

Pole  $10^7$  V/cm  $\Rightarrow$  disociace  $H_2O \Rightarrow OH^- + H^+$

2-elektrodový systém

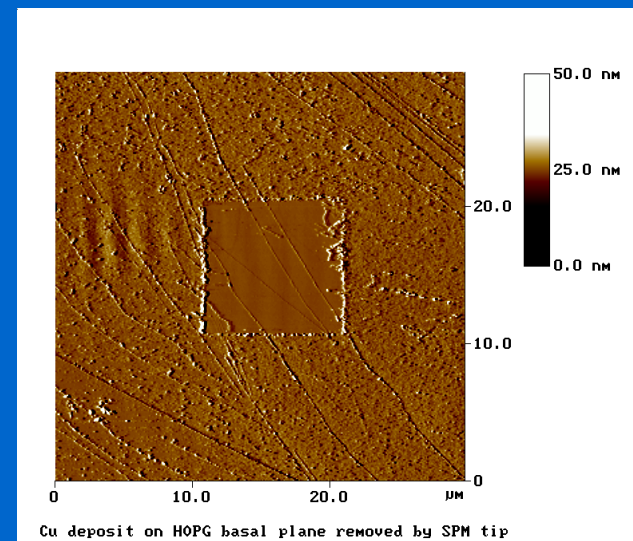
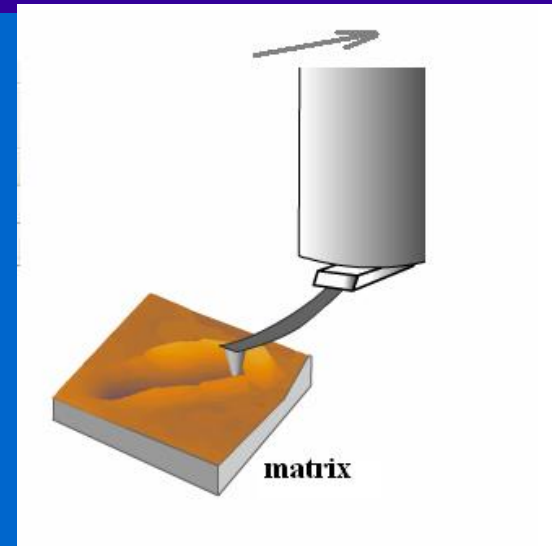
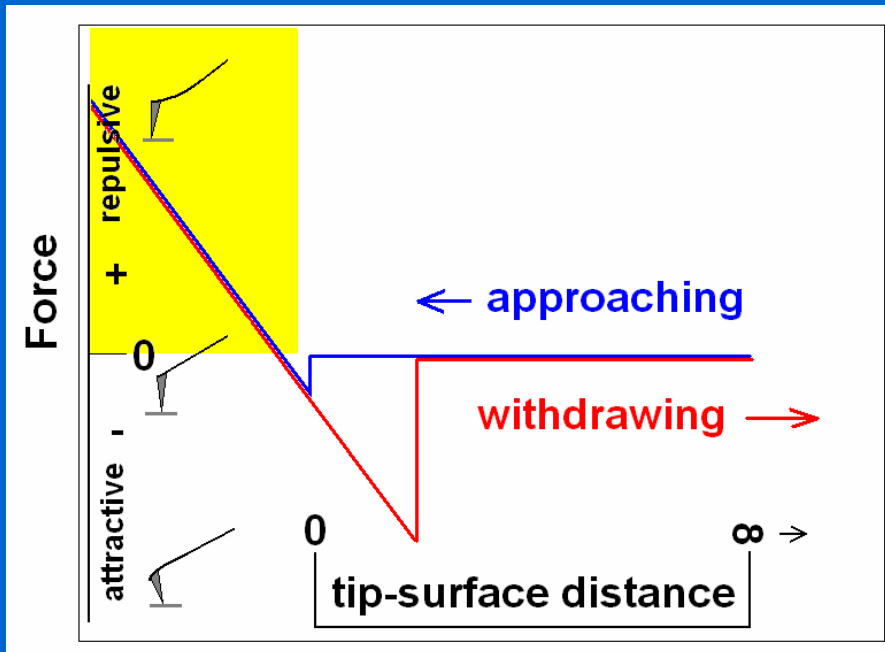


TSENG, Ampere A. *Tip-Based Nanofabrication Fundamentals and Applications*. Springer New York Dordrecht Heidelberg London 2011. ISBN 978-1-4419-9898-9.

- 
- 
- 

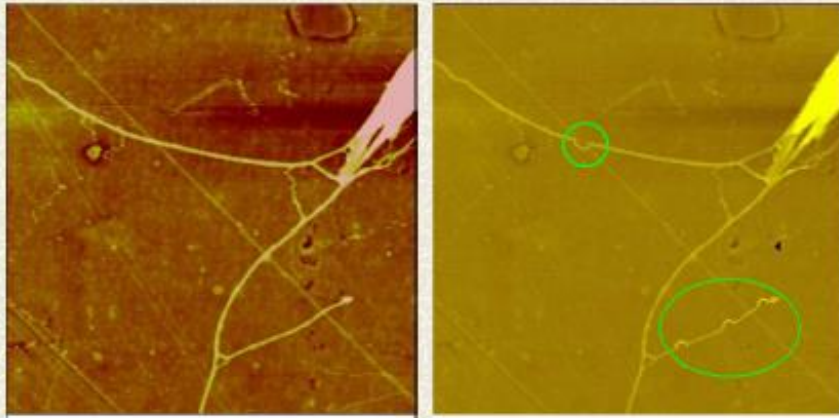
# SPM nanomanipulace & nanolithografie

# Interakce sonda-povrch vzorku



# Manipulace na molekulární úrovni

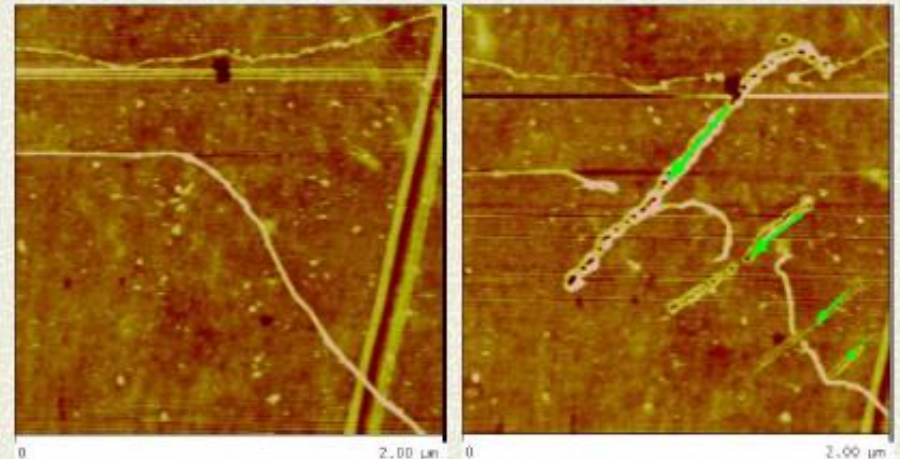
## DNA Manipulation: Pushing



Before pushing

After pushing

## DNA Manipulation: Cutting



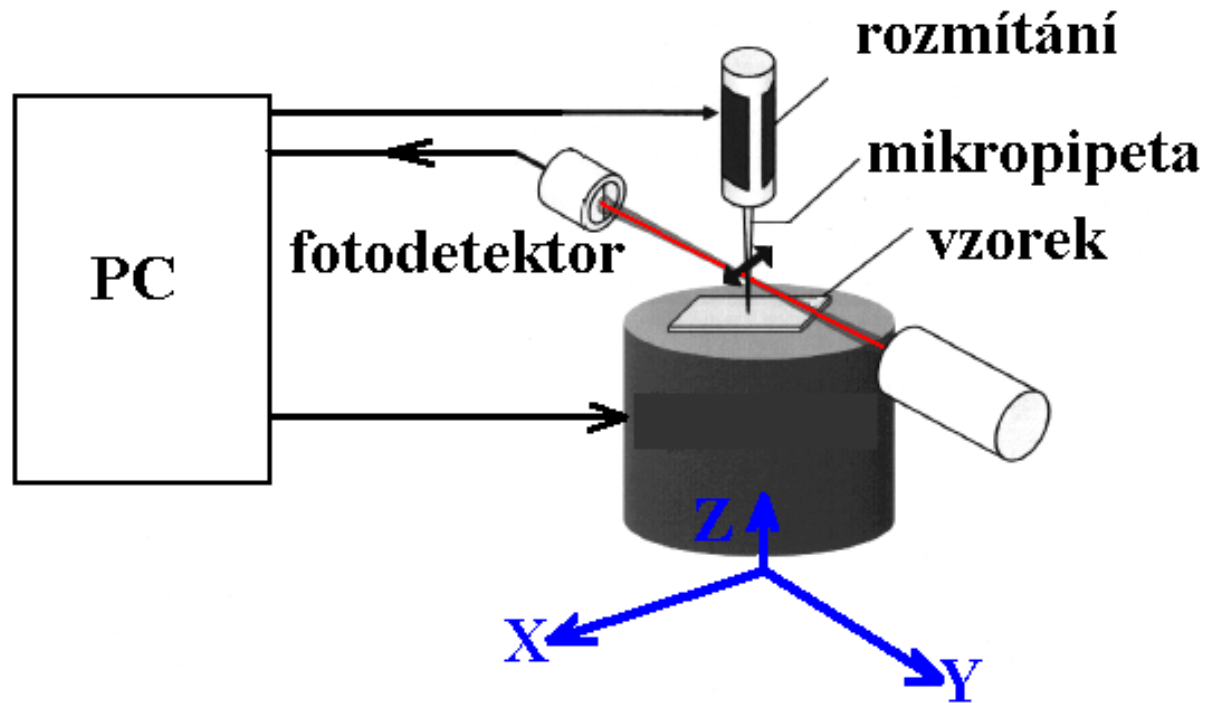
Before cutting

After cutting

**Ning Xi**

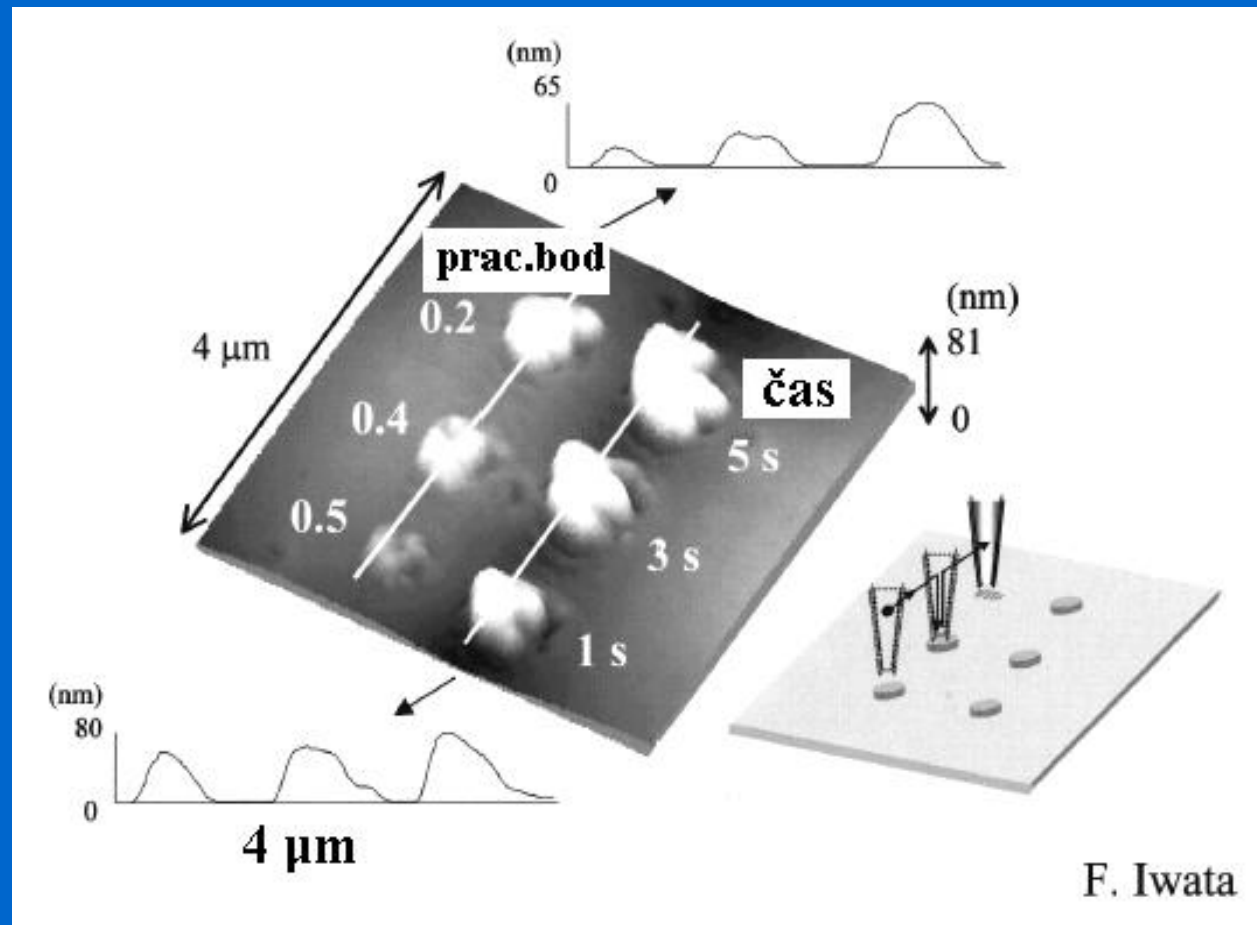
Department of Electrical and Computer Engineering  
Michigan State University

# Mikroskop s rastrovací mikropipetou



F. Iwata

# Nanolithografie AFM s rastrovací mikropipetou





Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, AVČR v.v.i.  
Dolejškova 3, 182 23 Praha 8

## Laboratoř mikroskopie rastrovací sondou

### AFM/STM Nanoscope IIIa Multimode (Bruker)

Pro práci v kapalinách a plynech  
Rozlišení ~ 0,1 nm

### AFM/STM TopoMetrix TMX 2010

Pro práci v kapalinách a plynech  
Rozlišení ~ 0,1 nm

### AFM Dimension Icon (Bruker)

pro práci v kapalinách a plynech



<http://www.jh-inst.cas.cz/~janda>  
pavel.janda@jh-inst.cas.cz

- 
- 
- 



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-